



SE 系列

SE 7441

安規綜合分析儀

使用說明書

V1.14

February 2023

校驗及校正聲明

華儀電子股份有限公司特別聲明，本系列產品完全符合華儀電子產品型錄上所標示的規範和特性，且在出廠前已通過廠內校驗，校驗的程序和步驟完全符合電子檢驗中心的規範和標準。

產品品質保證

華儀電子股份有限公司保證所生產製造的本系列產品均經過嚴格的品質確認，保證自出廠兩年內，在正常使用下，如果有施工瑕疵或零件故障，將負責免費給予修復，但如果有下列情形之一者，將不提供免費保修服務。

1. 非本公司生產的附屬設備或附件。
2. 非正常的使用、人為疏忽、或非人力可控制下產生的故障，例如地震、水災、暴動、或火災等。
3. 使用者自行更改電路、功能、或逕行修理本系列產品、零件或外箱造成的故障或損壞。
4. 機器蓋板接合處封條貼紙破損。

在兩年的保證期內，故障或損壞的產品，請送回本公司維修中心或指定的經銷商，華儀會予以妥善修護。

Compliance Information

Conforms with the following product standards:

EMC Standard

EN 61326-1:2013 Class A

EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013

EN 61326-1:2013 (Industrial Locations)

EN 61000-4-2:2009 / IEC 61000-4-2:2008

EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 / IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010

EN 61000-4-4:2012 / IEC 61000-4-4:2012

EN 61000-4-5:2006 / IEC 61000-4-5:2005

EN 61000-4-6:2014 / IEC 61000-4-6:2013

EN 61000-4-8:2010 / IEC 61000-4-8:2009

EN 61000-4-11:2004 / IEC 61000-4-11:2004

1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
3. Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

目錄

This manual is an interactive PDF. Click each heading below to jump directly to the topic you need. Web addresses are also interactive.

第一章 簡介.....	1
1.1 符號和標誌	1
1.2 技術用語彙篇(本技術用語使用於操作使用手冊內).....	2
1.3 安全規定	3
1.4 安規介紹.....	6
1.5 安規測試.....	6
第二章 安裝.....	9
2.1 拆封和檢查	9
2.2 安裝	10
第三章 技術規範.....	11
3.1 功能及規格	11
3.2 面板說明.....	18
3.3 背板說明.....	19
第四章 設定說明.....	20
4.1 系統參數(Setup System)設定.....	20
4.2 測試參數(Setup Tests)設定.....	33
4.3 自我檢測功能(FAIL-CHEK).....	42
4.4 安全設定(Security)	46
4.5 我的最愛(My Menu).....	48
第五章 操作說明.....	50
5.1 執行測試(Perform Tests)設定.....	50
5.2 訊息說明.....	54
5.3 操作程序及步驟	57
第六章 介面說明.....	59
6.1 標準遙控介面(Remote I/O)	59
6.2 USB & RS232/GPIB介面	61
6.3 IEEE-488 通信範例.....	82
附錄.....	83

第一章 簡介

高電壓測試前應該注意的規定和事項 !!!

1.1 符號和標誌

1.1.1 安規符號



小心標誌。請參考手冊上所列的警告和注意說明，避免人員受傷害或儀器損壞。



電擊危險標誌，可能會有高電壓存在，請避免接觸。



機體接地符號。

1.1.2 小心和警告標誌



警告標誌，警告使用者所執行的程序、應用、或條件均具有很高的危險性，若未依正確的操作程序，可能導致人員受傷或甚至死亡。



提醒標誌，提醒使用者必須注意所執行的程序、應用、或條件均可能造成本系列產品損壞或失掉產品內所有儲存的資料。

為防止意外傷害或死亡發生，在搬移和使用本系列產品時，請務必先觀察清楚標誌及相關說明，然後再進行動作。

1.2 技術用語彙篇(本技術用語使用於操作使用手冊內)

交流電壓(AC):有規則性和正負方向的電壓,目前世界上大都使用60Hz或50Hz的電壓。

耐壓崩潰(Breakdown):絕緣體在某些情況之下會發生電弧或電暈的現象,如果電壓逐漸被提升,絕緣體會在某一個電壓值突然崩潰,這時的電流的流量和電壓值不會成為等比例增加。

導電(Conductive):在每立方公分的體積內,其電阻值不超過1000歐姆,或每平方公分的表面積內,其電阻值不超過100000歐姆。

導電體(Conductor):一種固體或液體物質,可以讓電流流過,在每立方公分的體積內,其電阻值不超過1000歐姆。

電流(Current):電子在導體上的流動,其量測單位為安培(ampere)、毫安培(milliamperere)、或微安培(microampere)等,其代表符號為I。

介電體(Dielectric):在兩個導電體之間的絕緣物質,可以讓兩個導電體產生充電現象或出現電位差。

直流電(DC):電流只流向單一方向,具有極性的特點,一端的電位永遠較另外一端為高。

耐壓測試器(Hipot Tester):通常應用在介電體耐壓的測試儀器。

絕緣體(Insulation):具有1000G /cm的氣體、液體或固體,其目的在於避免電流在兩導電體之間流通。

絕緣電阻測試器(Insulation Resistance Tester):一種具有電阻量測到200M 以上能力的儀器,一般都必須在電阻錶內使用一個高壓電源供應器,量測能力才能超過200 M 以上。

洩漏電流(Leakage):AC或DC電流流經絕緣體或其表面,在AC方面也同時會流經電容體,電流的流量和電壓成正比例。絕緣或電容體的阻抗值為恆定,除非發生耐壓崩潰的現象。

電阻(Resistance):一種可以阻止電流通的物質,在電流通過這種物質後,會用產生熱量作為表現的方式,單位為Ohm(),代表符號為R。

跳脫點(Trip Point):在介電耐壓測試時可以被判定為不可接受條件的最低電流量。

電壓(Voltage):電子流在兩導體之間的壓力,通常為驅動電流在導體上流通的壓力,代表符號為V。

1.3 安全規定

- 在開始使用之前，請先了解本系列產品所有使用和相關的安全標誌，以策安全。
- 本系列產品所引用的安全規範為Safety Class I(機體具有保護用的接地端子)的規定。
- 在開啟本系列的輸入電源開關前，請先選擇正確的輸入電壓，詳細輸入資訊請參考第三章技術規範。



本系列產品的電壓和電流足以造成人員傷害或感電，為了防止意外傷害或死亡發生，在搬移或使用本系列時，請務必先觀察清楚標誌及相關說明，然後再進行動作。

1.3.1 維護和保養

使用者的維護

本系列產品內部所有的零件，絕對不需使用者的維護，請勿掀開儀器的外殼，避免感電。若要進行外部清潔，請以乾淨的擦拭布擦示即可，不要使用清潔劑或化學溶劑，避免塑膠零件(如控制按鍵和開關)或印刷文字的損壞。如果本系列有異常情況發生，請向華儀電子或指定的經銷商尋求維護，或歡迎利用華儀官網的聯絡我們和我們聯繫

華儀官網

<http://www.ikonixasia.com/>

定期維護

本系列產品和相關附件每年至少要仔細檢驗和校驗一次，以保護使用者的安全和確保儀器的精確性。

使用者的修改

使用者不得自行更改本系列產品的線路或零件，如有自行更改，或有使用未經華儀認可的零件或附件，該儀器的保證期將自動失效，且華儀不負任何維修或未經許可造成的相關責任。如發現回廠檢修的本系列被自行更改或是用非認可的零件，華儀會將儀器的電路或零件修復成原來設計的狀態，並收取修復費用。

1.3.2 測試工作站

工作站位置

因本系列產品有高電壓輸出，工作站必須安排在一般人員不需要經過的地方，避免危險，但如果作業安排無法避免時，必須將工作站與其它設施隔開來並且須特別標明"高壓測試工作站"。如果高壓測試工作站與其它作業站非常接近時，必須特別注意安全的問題，且在進行高壓測試時，必須標明**"危險！高壓測試進行中，非工作人員請勿靠近"**。

工作場所

儘可能使用非導電材質的工作桌工作台。操作人員和待測物之間不得使用任何金屬，且不得跨越被測物操作或調整本系列產品。如果被測物體積很小，儘可能將它放置於非導電的箱體內，例如壓克力箱等。

工作場所必須隨時保持整齊、乾淨，不得雜亂無章。儀器和測試線要做測試中物件、待測物件、和已測物件的狀態標示，且要讓所有人員都能快速識別，而不使用的儀器和測試線請放至固定位置。

工作場所及其周邊的空氣中不能含有可燃氣體，亦不可以在易燃物質的旁邊使用本系列產品。

輸入電源

本系列產品必須要有良好的接地，作業前務必接妥地線，以確保人員安全。工作站的電源必須有獨立的開關及裝置於入口顯眼處，且並須做特別標示讓所有的人員都能輕易辨別，若一旦有緊急事故發生時，即可立即關閉電源，再做事故處理。

1.3.3 操作人員規定

人員資格



本系列產品所輸出的電壓和電流在異常操作時，足以造成人員傷害或致命，請務必由訓練合格的人員使用和操作。

安全守則

操作人員必須隨時給予教育和訓練，使其了解各種操作的規則及其重要性，以便能依安全規則操作本系列產品。

衣著規定

操作人員請勿穿戴具有金屬裝飾的衣服或飾品，以避免感電造成危險。

醫學規定

請勿讓有心臟病或配戴心律調整器的人員操作本系列產品。

1.3.4 測試安全程序規定

如果儀器有外部安全接地接點，請確認接地接點已被接受，並請特別注意，開機前必須確認已將高壓回線(Return)接妥，而要進行測試時才將高壓測試線接上。使用高壓測試線(夾)時必須握在絕緣部份——絕對不能直接觸摸高壓輸出端(夾)，而且操作人員必須能夠完全掌控本儀器的控制開關及遙控開關，遙控開關必須放置於固定位置。



本系列產品安規測試器的高壓回線(Return)並未直接接地。這樣的設計可以量測到極微量的漏電流，但是在進行測試時，被測物必須與地線和大地完全絕緣，避免無法量測到電流或量測到的電流值不準確。若需更詳細的資訊，請與華儀電子客支部連繫。



測試進行中，請勿碰觸測試物件或任何與待測物有連接的物件。

1.3.5 安全注意事項

- 非合格的操作人員和不相關的人員應遠離高壓測試區。
- 隨時保持高壓測試區是在安全和有秩序的環境及狀態。
- 若有任何異常發生，請立即關閉高壓輸出。
- 直流耐壓測試完成後，請務必先對待測物進行放電，再拆除連接的測試線。

1.4 安規介紹

安規測試的重要性與使用者的安全

在消費意識高漲的現今世界，每一個電氣和電子產品的製造商，必須盡最大的能力，將產品的安全做好。每一種產品的設計必須盡其可能，不讓使用者有被感電的機會。縱然是使用者發生錯誤使用也應無感電機會。為了達到一般公認的安全要求，"耐壓測試器"就必須被使用。安規執行單位、例如UL、CSA、IEC、BSI、VDE、TUV和JSI等都要求各製造商在設計和生產電子或電氣產品時要使用"耐壓測試器"作為安全測試。這些安規執行單位有時也會要求某些產品必須做絕緣電阻測試、接地電阻測試，甚至要求做洩漏電流測試。

1.5 安規測試

1.5.1 耐壓測試(Dielectric Withstand Voltage Test)

耐壓測試的基礎理論是將一個產品暴露在非常惡劣的環境之下，如果產品能夠在這種惡劣的環境之下還能維持正常狀況，就可以確定在正常的環境之下工作，也一定可以維持很正常的狀況。最常使用耐壓測試的情況為：

- 設計時的功能測試：確定所設計的產品能達到其功能要求的條件。
- 生產時的規格測試：確認所生產的產品能達到其規格要求的標準。
- 品保時的確認測試：確認產品的品質能符合安規的標準。
- 維修後的安全測試：確認維修後的產品能維持符合安規的標準。

不同的產品有不同的技術規格，基本上在耐壓測試時是將一個高於正常工作的電壓加在產品上測試，這個電壓必須持續一段規定的時間。如果一個零組件在規定的時間內，其漏電電流量亦保持在規定的範圍內，就可以確定這個零組件在正常的條件下運轉，應該是非常安全。而優良的設計和選擇良好的絕緣材料可以保護使用者，讓他免予受到意外感電。

本儀器所做的耐壓測試，一般稱之為"高電壓介電測試"，簡稱為"耐壓測試"。基本的規定是以兩倍於被測物的工作電壓，再加一千伏特，作為測試的電壓標準。有些產品的測試電壓可能高於 $2 \times \text{工作電壓} + 1000 \text{ V}$ 。

例如有些產品的工作電壓範圍是從100V到240V，這類產品的測試電壓可能在1000V到4000V之間或更高。一般而言，具有"雙重絕緣"設計的產品，其使用的測試電壓可能高於 $2 \times \text{工作電壓} + 1000 \text{ V}$ 的標準。

耐壓測試在產品的設計和樣品製作時比正式生產時的測試更為精密，因為產品在設計測試階段便已決定產品的安全性。雖然在產品設計時只是用少數的樣品來作判斷，然而生產時的線上測試更應嚴格要求所有的產品都必須能通過安規標準，可以確認沒有不良品會流出生產線。

耐壓測試器的輸出電壓必須保持在規定電壓的100%到120%的範圍內。AC耐壓測試器的輸出頻率必須維持在40到70Hz之間，同時其波峰值不得低於均方根(RMS)電壓值的1.3倍，並且其波峰值不得高於均方根(RMS)電壓值的1.5倍。

高壓測試能檢測出下列狀況

- 絕緣材料的絕緣強度太弱
- 絕緣體上有針孔
- 零組件之間的距離不夠
- 絕緣體被擠壓而破裂

1.5.1.1 交流耐壓(ACW)測試的優缺點

請先與受測試產品所指定的安規單位確認該產品應該使用何種電壓，有些產品可以同時接受直流和交流兩種測試選擇，但是仍然有多種產品只允許接受直流或交流中的一種測試。如果安規規範允許同時接受直流或交流測試，製造廠就可以自己決定何種測試對於產品較為適當。為了達成此目地，使用者必須了解直流和交流測試的優缺點。

交流耐壓(ACW)測試的特點

大部份做耐壓測試的被測物都會含有一些雜散電容量。用交流測試時可能無法充飽這些雜散電容，會有一個持續電流流過這些雜散電容。

交流耐壓(ACW)測試的優點

1. 一般而言，交流測試比直流測試更容易被安規單位接受。主因是大部份的產品都使用交流電，而交流測試可以同時對產品作正負極性的測試，與產品使用的環境完全一致，合乎實際使用狀況。
2. 由於交流測試時無法充飽那些雜散電容，但不會有瞬間衝擊電流發生，因此不需讓測試電壓緩慢上升，可以一開始測試就全電壓加上，除非這種產品對衝擊電壓很敏感。
3. 由於交流測試不會對電容充電，在測試後不必對測試物作放電的動作，這是另外一個優點。

交流耐壓(ACW)測試的缺點

1. 主要的缺點為，如果被測物的雜散電容量很大時，這樣所產生的電流，會遠大於實際的漏電電流，因而無法得知實際的漏電電流。
2. 另外一個缺點是由於必須供應被測物的雜散電容所需的電流，機器所需輸出的電流會比採用直流測試時的電流大很多。這樣會增加操作人員的危險性。

1.5.1.2 直流耐壓(DCW)測試的優缺點

直流耐壓(DCW)測試的特點s

在直流耐壓測試時，被測物上的雜散電容會被充滿，直流耐壓測試時所造成的容性電流，在雜散電容被充滿後，會下降到趨近於零。

直流耐壓(DCW)測試的優點

一旦被測物上的雜散電容被充滿，只會剩下被測物實際的漏電電流。直流耐壓測試可以很清楚的顯示出被測物實際的漏電電流。

另外一個優點是由於僅需在短時間內，供應被測物的充電電流，其它時間所需供應的電流非常小，所以機器的電流容量遠低於交流耐壓測試時所需的電流容量。

直流耐壓(DCW)測試的缺點

1. 除非被測物上沒有任何電容量存在，否則測試電壓必須由"零"開始，緩慢上升，以避免充電電流過大，電容量越大所需的緩升時間越長，一次所能增加的電壓也越低。充電電流過大時，一定會引起測試器的誤判，使測試的結果不正確。
2. 由於直流耐壓測試會對被測物充電，所以在測試後，一定要先對被測物放電，才能做下一步工作。
3. 與交流測試不一樣，直流耐壓測試只能單一極性測試，如果產品要使用於交流電壓下，這個缺點必須被考慮。這也是大多數安規單位都建議使用交流耐壓測試的原因。
4. 在交流耐壓測試時，電壓的波峰值是電錶顯示值的1.4倍，這一點是一般電錶所不能顯示的，也是直流耐壓測試所無法達到的。所以多數安規單位都要求，如果使用直流耐壓測試，必須提高測試電壓到相等的數值。

1.5.2 絕緣電阻測試(Insulation Resistance Test)

新設計的一些安規分析儀大都將絕緣電阻測試的功能含蓋在內，基本上絕緣電阻測試功能必須提供一個500到1000VDC的電壓，同時電阻的量測範圍也必須可以由幾百K 量測到幾個G。這些功能可以讓產品的製造廠符合安全要求的規定，TUV和VDE等安規執行單位在某些特定的產品會要求先做絕緣電阻的測試，然後才能執行耐壓測試，這項規定目前大都被引用在產品設計所執行的安規試驗上。

絕緣電阻測試的基本理論與耐壓測試非常類似，耐壓測試的判定是以漏電流量為基準，而絕緣電阻測試則以電阻值的形態作為判定依據，通常必須為多少M 以上。

絕緣電阻值越高表示產品的絕緣越好。絕緣電阻測試的接線方式與耐壓測試完全相同，量測到的絕緣電阻值為兩個測試點之間以及其週邊連接在一起的各項關連網路所形成的等效電阻值。

華儀電子的安規測試設備內所含蓋的絕緣電阻測試功能，是一項獨立的測試功能，不會與耐壓測試的功能互相重疊，使用上更為簡便。

1.5.3 接地電阻測試(Ground Continuity Test or Ground Bond Test)

接地電阻測試的主要目的為確定被測物在故障的情況之下，安全接地線是否能承擔故障的電流流量，接地的電阻值必須越低越好，這樣才能確認一旦產品發生故障時，在輸入的電源開關尚未切斷電源以前，可以讓使用者免於感電的危險和威脅。

第二章 安裝

本章主要介紹華儀電子產品的拆封、檢查、使用前的準備、和儲存等的規則。打開包裝，在操作儀器前請檢查箱內物品，若有不符、缺失或外觀磨損等情況，請立即與華儀電子聯繫。包裝箱內容包括：

項目	SE 7441
	數量
電源線 (10A)	1
保險絲	1
1101 耐壓輸出線	1
1137 接地阻抗輸出線	1
1138 接地阻抗迴路線	1
1109 Hipot Output Lead	8
1224 USB 連接線	1
1505 Interlock Disable Key	1
鉤型端子	20
出廠報告	1

2.1 拆封和檢查

2.1.1 包裝

華儀電子的產品使用含有泡棉保護的包裝箱作防護，如果收到產品時包裝箱有破損，請檢查機器的外觀有無變形、刮傷、或面板損壞等問題。如果有損壞，請立即通知華儀電子或指定的經銷商以進行產品修護或更換新機，並請保留原包裝箱和泡棉，以便了解發生的原因。產品退回前，請先和華儀電子或指定經銷商聯繫，在未聯繫前，請勿先退回產品。

2.1.2 包裝方式

原始包裝

請保留所有的原始包裝材料，如果儀器必須回廠維修，請用原來的包裝材料包裝。並請先與華儀電子的維修中心連絡。送修時，請務必將電源線和測試線等全部的附件一起送回，並註明故障現象和原因。另外，請在包裝上註明“易碎品”請小心搬運。

其它包裝

如果無法找到原始材料包裝，請依下列步驟及說明進行產品包裝：

1. 先用氣泡布或保麗龍將儀器包妥。
2. 再將儀器置於可以承受150KG(350lb.)的多層紙箱包裝。
3. 儀器的面板必須先用厚紙板保護，儀器週圍必須使用可防震的材料填充，厚度大約為70到100mm(3到4inch)。
4. 妥善密封箱體。
5. 註明"易碎品"請小心搬運。

2.2 安裝

2.2.1 工作場所



在接上輸入電源之前，必須先確認電源線上的地線已被接受，同時請將地線連接於機體的接地端子上。本儀器使用三芯的電纜線，電源插頭只能插在帶有地線的電源插座上，如果使用延長線，請必須注意延長線是否具有接地線，如果電源線插到具有地線的插座或端子時，即

完成機體接地。

2.2.2 輸入電源的需求

本系列產品使用100-120VAC 或200-240VAC 10% 47-63 Hz的單相電源，儀器會自動偵測輸入電源的電壓，不需切換輸入電壓之開關。在開啟本系列的電源開關前，請使用正確規格的保險絲。更換保險絲前，務必先關閉輸入電源，以避免危險。

請依第三章節 技術規範中使用的保險絲，或參考儀器背板上標示的規格更換保險絲，請勿任意變更保險絲的規格。

2.2.3 環境條件

本系列可以在下列環境下被使用，儲存和運輸，而要進行絕緣阻抗(IR)量測前，請先暖機30分鐘。

操作環境

溫度：0 -40 C(32 -104 F)。

相對濕度：20到80%之間。

高度：海拔2000公尺(6500英呎)以下。

儲存和運輸環境

週圍溫度：-40 到75 C

高度：海拔7620公尺(25000英呎)

本機必須避免溫度的急劇變化，溫度急劇變化可能會使水氣凝結於機體內部。

=====

備註：儀器上方請勿施加重量，避免上蓋變形。

=====

第三章 技術規範

3.1 功能及規格

MODEL	ACW	DCW	IR	GND	CONT.	Built-in Scanner
SE 7441	V	V	V	V	Option	V

MODEL	SE 7441			
AC WITHSTAND VOLTAGE				
Output Rating	5KVAC/40mA			
Output Rating(OPT.7015)	6KVAC/30mA			
	Range		Resolution	Accuracy
Output Voltage, kV	0-5.00		0.01	±(1% of Setting + 0.5% of Range)
Output Voltage, kV(OPT.7015)	0-6.00		0.01	±(1% of Setting + 0.5% of Range)
Output Frequency	50Hz/60Hz ± 0.1%, User Selectable			
Output Waveform	Sine Wave, Crest Factor = 1.3-1.5			
Output Regulation	±(1% of output + 5V), From no load to full load			
Hi and Lo-Limit (Total) current, mA	Auto Range	10.00-40.00	0.01	±(2% of Setting + 2 counts)
				±(2% of Setting + 6 counts)
	Fixed Range	3.51-40.00	0.01	±(2% of Setting + 2 counts)
				±(2% of Setting + 6 counts)
Hi and Lo-Limit (Real) current, mA	Auto Range	10.00-40.00	0.01	±(3% of Setting + 50µA)
Ramp Up Timer, Second	0.1-999.9		0.01	±(0.1% of Setting + 0.05s)
Ramp Down Timer, Second	0.0-999.9			
Dwell Time, Second	Auto Range	0, 0.1-999.9 (0=continuous)	0.01	±(0.1% of Setting + 0.05s)
	Fixed Range	0, 0.2-999.9 (0=continuous)		
Current Offset	0.000-40.00mA(Total current + current Offset ≤40mA) 7441 0.000-100.0mA(Total current + current Offset ≤100mA) for SE 7451 & SE 7452			
Arc Detection	The range is from 1-9(9 is the most Sensitive)			

DC WITHSTAND VOLTAGE

Output Rating	6KVDC/10mA			
Output Rating(OPT.7015)	7.5KVDC/10mA			
Output Voltage, kVdc	0.01			
Output Voltage, kVdc (OPT.7015)	0.01			
Output Ripple	< 4%(6KV/10mA at Resistive Load)			
Hi and Lo-Limit (Total) current, mA	Auto Range	0.0000-0.9999	0.0001	±(2% of Setting + 10 counts) Low Range is ON.
		1.000-9.999	0.001	
		10.00-99.99	0.01	
		100.0-999.9	0.1	±(2% of Setting + 2 counts)
		1000-10000	1	
	Fixed Range	0.0000-0.3500	0.0001	±(2% of Setting + 10 counts) Low Range is ON.
		0.351-3.500	0.001	
		3.51-35.00	0.01	
		35.1-350.0	0.1	±(2% of Setting + 2 counts)
		351-3500	1	
		3501 – 10000	1	
Ramp Up Timer, Second	0.4-999.9 (Low Range = OFF) 0.1-999.9 (when fixed range is ON)		0.01	±(0.1% of Setting + 0.05s)
	0.5-999.9 (Low Range = ON)			
Ramp Down Timer, Second	0.0, 1.0-999.9			
Dwell Time, Second	0, 0.4-999.9 , (Low Range = OFF) (0=continuous)			
	0, 1.0-999.9 , (Low Range = ON) (0=continuous)			
	0, 0.1-999.9s, when it be select fixed range (if low range is ON , the time will follow low range setting)			

Ramp-HI, current , uA	Low Range is ON	0.0000-0.9999	0.0001	±(2% of Setting + 10 counts)
		1.000-9.999	0.001	
		10.00-99.99	0.01	
		100.0-999.9	0.1	±(2% of Setting + 2 counts)
		1000-10000	1	
	Low Range is OFF	0.0-999.9	0.1	
		1000-10000	1	
Charge LO, current, uA	0.0-350.0 μA DC or Auto Set, When current range is 3 ranges. 0-3500 nA DC or Auto Set, When current range is 6 ranges.			
Discharge Time	< 50 msec for no load, < 100 msec for capcitor load(all capacitance values in MAX load spec below)			
Maximum Capacitive Load DC Mode	1μF < 1KV, 0.75μF < 2KV, 0.5μF < 3KV, 0.08μF < 4KV, 0.04μF < 5KV, 0.015uF < 6KV			
Current Offset	0.0-10000uA(Total current + current Offset ≤10mA)			
Arc Detection	The range is from 1-9(9 is the most Sensitive)			
INSULATION RESISTANCE				
Output Rating	6KVDC/50000MΩ			
Output Voltage, Vdc	10-6000	1	±(1% of Setting + 0.5% of Range)	
HI and LO-Limit, resistance, MΩ	0.10-99.99 (HI-Limit: 0 = OFF)	0.01	±(0.1% Setting)	
	100.0-999.9	0.1		
	1000 – 50000	1		
Resistance Measurement	0.05-999MΩ (under 10-29V)	0.001/0.01/0.1 MΩ	±(15% of Reading + 2 counts)	
	0.05-999MΩ (under 30-499V)	0.001/0.01/0.1 MΩ	±(7% of Reading + 2 counts)	
	0.100-999.9MΩ (under 500-6000V)	0.001/0.01/0.1 MΩ	±(2% of Reading + 2 counts)	
	1000-9999MΩ (under 500-6000V)	1 MΩ	±(5% of Reading + 2 counts)	
	10000-50000MΩ (under 500-6000V)	1 MΩ	±(15% of Reading + 2 counts)	

Ramp Up Timer, Second	0.1-999.9	0.1	±(0.1% Setting+ 0.05s)
Ramp Down Timer, Second	0.0, 1.0-999.9		
Dwell Time, Second	0, 0.5-999.9(0 = continuous)		
Delay Timer, Second	0.5-999.9		
Charge LO, current, uA	0.000-3.500, auto/manual Set		
GROUND BOND			
Output Rating	32A/600mΩ/8V		
Output AC Current, A	1.00-32.00	0.01	±(2 % of Setting + 0.5% of Range)
Output Voltage, Vac Open Circuit Mode	1.00-40.00	0.01	±(2 % of Setting + 3 counts)O.C.
Output Frequency, Hz	50Hz/60Hz ± 0.1%, User Selectable		
Output Regulation	±(1% of output + 0.02A), Within maximum load limits, and over input voltage range.		
Maximum Loading	1.00-10.00A / 0-600mΩ , 10.01-32.00A / 0-200mΩ		
Lead Resistance Offset, mΩ	0-200	1	±(2% of Setting + 2 counts)at current > 3A
HI and LO-Limit Resistance, mΩ	0-200 (10.01-32.00A)	1	±(2% of Setting + 2 counts)
	0-600 (6.00-10.00A)		
	0-600 (1.00-5.99A)		±(3% of Setting + 3 counts)at current > 3A
Dwell Timer, Second	0, 0.5-999.9(0 = continuous)	0.1	±(0.1% of Setting + 0.05s)
CONTINUITY (Option)			
Output Rating	1A for 1.000 Ohm , 0.1A for 10.00 Ohm , 0.01A for 100.0 Ohm , 0.001A for 1000 Ohm , 0.0001A for 10000 Ohm		
HI and LO-Limit, Ω	0.000-1.000	0.001	±(1% of Setting + 3 counts)
	1.01-10.00	0.01	
	10.1-100.0	0.1	
	101-1000	1	
	1001-10000	1	±(1% of Setting + 10 counts)
Dwell Timer, Second	0.0, 0.4-999.9(0 = continuous)	0.1	±(0.1% of Setting + 0.05s)
Resistance Offset, Ω	0.000-10.00	0.001/0.01	±(1% of reading + 3 counts)

Measurement			
	Range	Resolution	Accuracy
Voltage, KV(AC/DC)	0.00-7.50	0.01	$\pm(1\% \text{ of reading} + 0.5\% \text{ of Range})$
Voltage, Vdc (IR only)	0-1000	1	$\pm(1\% \text{ of reading} + 0.5\% \text{ of Range})$
	1001-6000	1	$\pm(1\% \text{ of reading} + 0.5\% \text{ of Range})$
AC Total Current, mA (Auto range)	0.000-3.500	0.001	$\pm(2\% \text{ of reading} + 3 \text{ counts})$
	3.00-40.00	0.01	
AC Total Current, mA (Fixed range)	0.000-3.500	0.001	$\pm(2\% \text{ of reading} + 2 \text{ counts})$
	0.00-40.00	0.01	$\pm(2\% \text{ of reading} + 2 \text{ counts})$ Additional error when reading < 6% of range for $\pm(0.1\% \text{ of range})$
AC Real Current , mA	0.000-9.999	0.001	$\pm(3\% \text{ of reading} + 50\mu\text{A})$ All Ranges PF > 0.1 , V > 250VAC
	10.00-99.99	0.01	
DC Current, nA (Auto/Fixed Range)	0.0-350.0	0.1	$\pm(2\% \text{ of reading} + 10 \text{ counts})$ Low Range is ON.
DC Current, μA (Auto Range)	0.300-3.500	0.001	
	3.00-35.00	0.01	
	30.0-350.0	0.1	$\pm(2\% \text{ of reading} + 2 \text{ counts})$
DC Current, μA (Fixed Range)	0.000-3.500	0.001	$\pm(2\% \text{ of reading} + 10 \text{ counts})$ Low Range is ON. Additional error when reading < 6% of range for $\pm(0.1\% \text{ of range})$
	0.00-35.00	0.01	
	00.0-350.0	0.1	$\pm(2\% \text{ of reading} + 2 \text{ counts})$
DC Current, mA (Auto Range)	0.300-3.500	0.001	
	3.00-10.00	0.01	

DC Current, mA (Fixed Range)	0.000-3.500	0.001	±(2% of reading + 2 counts) Additional error when reading < 6% of range for ±(0.1% of range)
	0.00-10.00	0.01	±(2% of reading + 2 counts) Additional error when reading < 6% of range for ±(0.2% of range)
AC Current, A (GB)	0.00-40.00	0.01	±(2% of reading + 0.5% of Range)
Resistance, mΩ (GB)	0-600	1	3.00-32.00 A, ±(2 % of reading + 2 counts)
Resistance, Ω (Continuity)	0.000-1.000	0.001	±(1% of reading + 3 counts)
	1.01-10.00	0.01	
	10.1-100.0	0.1	
	101-1000	1	
	1001-10000	1	±(1% of reading + 10 counts)

GENERAL

Input Voltage AC	200-240V ± 10% , 50/60Hz ± 5%, max. current 6.3A
PLC Remote Control	Input: Test, ReSet, Interlock, Recall File 1 through 15
	Output: Pass, Fail, Test-in-Process
Memory	2000 steps, allow the User create different memories and steps. But each memory limit max. 200 steps and results
Display	4.3"Color Display(Touch Panel)
Calibration	Build-in software and external calibrated meters
Alarm Volume Setting	Range: 0-9; 0 = OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume
Built-in Scanner Module	YES
External Scanner Port	YES
USB & RS232 Interface	YES
GPIB Interface	OPTION

Multinational Language	The operating screen can Select different language including English/Traditional Chinese/Simplified Chinese/Japanese
CE Compliance	YES
Environment	0-40°C, 20-80%RH
Dimension(W × H × D), mm	430 × 133 × 400
Weight	20Kg

*產品規格如有更新, 將不另行通知.

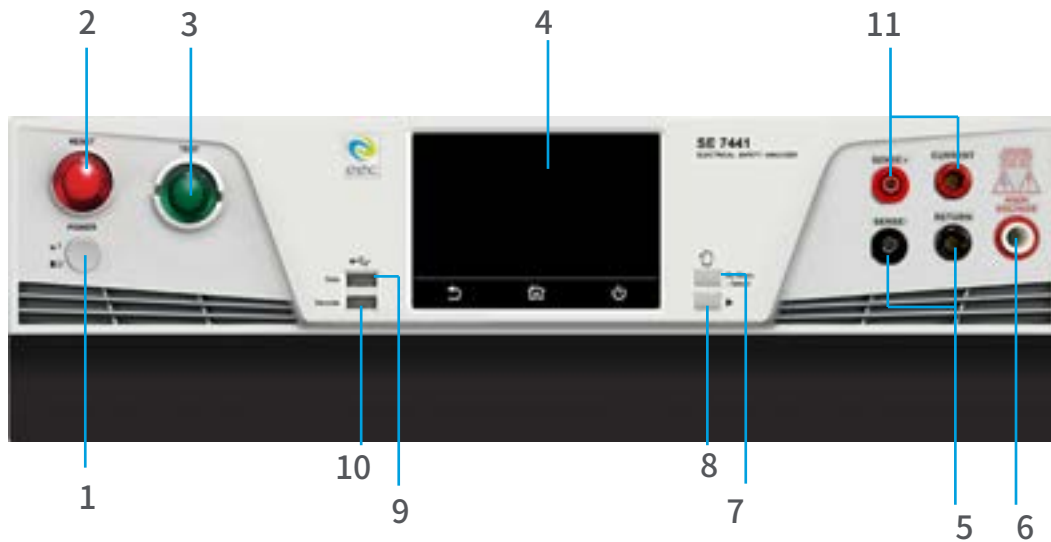
1. Environment requirement: humidity < 60% RH (no condensation, no scanner), When I < 150nA.
2. Only one interface can be selected among RS232 & USB, GPIB & Ethernet interface card.

【Ordering Information】

OPT.798 True Negative Voltage for DCW and IR
OPT.799 GB Output 40A
OPT.7009 JigA/JigB
OPT.7015 6KVAC/7.5KVDC Output

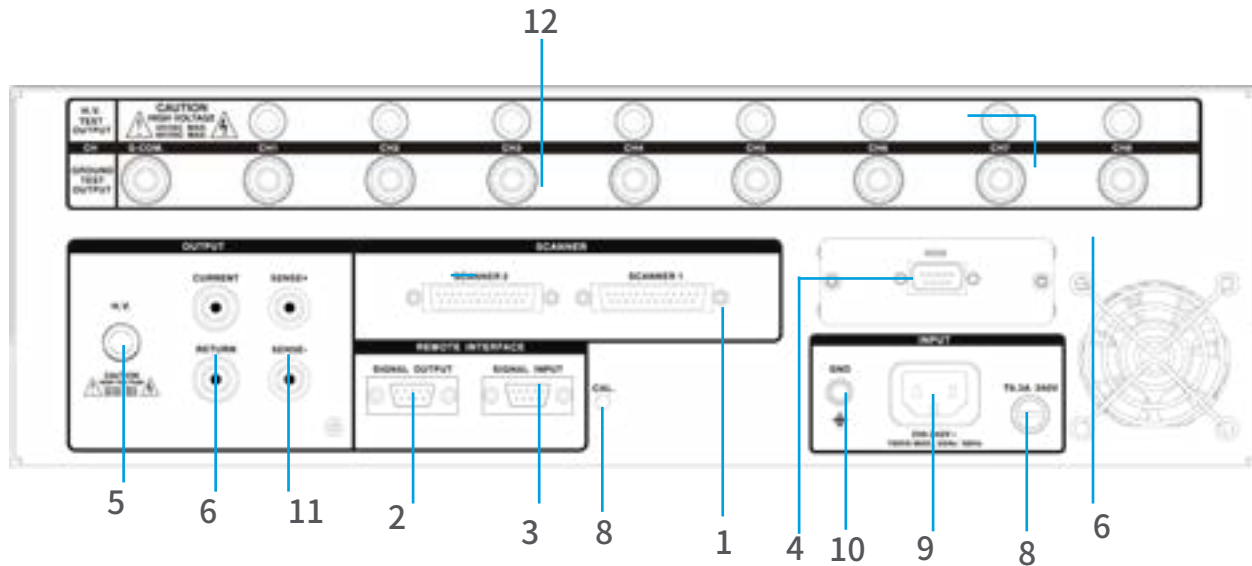
- Note: 1. Only one Option can be selected among OPT.7004, OPT.7006 & OPT.7015.
2. When selecting OPT.7015, AC Withstand Output change to 5kV/30mA

3.2 面板說明



1. **POWER輸入電源開關:** 標有國際標準"1"(ON)和"0"(OFF)符號的開關,作為輸入的電源開關。
2. **RESET開關:** 紅色的瞬時接觸開關同時內含FAIL的指示燈。在設定模式時其功能和EXIT鍵相同,可以作為離開設定模式的開關。在測試進行時,作為關閉警報聲進入下一個待測狀態的開關。在測試進行之中,也可以作為中斷測試的開關。在待測物未能通過測試時,這個紅色指示燈會亮。
3. **TEST開關:** 綠色的瞬時接觸開關同時內含PASS的指示燈,作為測試的起動開關。在待測物通過測試時,這個綠色指示燈會亮。
4. **電容式觸控面板:** 4.3吋彩色觸控螢幕,作為顯示設定資料或測試結果的顯示器。
5. **RETURN端子:** 回線端子。
6. **H. V. 端子:** 高壓輸出端子。
7. **高電壓標誌:** 當儀器開始輸出電壓時,高電壓標誌內的指示燈會閃爍,表示"高電壓輸出中、危險"。
8. **散熱孔:** 請保持良好的排風散熱空間。
9. **Data連接埠:** 可連接USB Disk來儲存測試結果與儲存設定參數。
備註:使用下列品牌的隨身碟比較不會有相容性問題:
題:ADATA、Apotop、Ridata、SanDisk、Team、Transcend、Kingston、Verbatim
介面:USB 2.0
USB Disk 容量限制:32GB(含)以下
相容格式:FAT 16 或 FAT 32
10. **Barcode連接埠:** 可連接掃描條碼器。
備註:
 1. 掃描條碼的格式請使用 code 128
 2. 支援CINO, Honeywell, Metrologic, DENSO, AIDA.b. Support CINO-F680, Honeywell, Metrologic, DENSO.
11. **CURRENT端子:** 接地阻抗測試的電流輸出端子。

3.3 背板說明



1. **SCANNER 端子:** 外接矩陣式掃描器 #1(#2)控制端子排。
2. **SIGNAL OUTPUT端子:** 遙控訊號輸出端子排，D型(9PIN)端子排母座，使用繼電器(RELAY)接點輸出PASS、FAIL和PROCESSING等功能的訊號，以供遙控裝置使用。
3. **SIGNAL INPUT端子:** 遙控訊號輸入端子排，D型(9PIN)端子排公座，可以輸入TEST和RESET的控制訊號，以及選擇執行記憶組 #1、#2和 #3等功能的遙控輸入訊號。
4. **INTERFACE裝置:** 嵌入式介面槽，本儀器所附之標準介面為 USB & RS232卡，可以另行選擇裝購 GPIB Card、Ethernet Card使用。
5. **H. V.端子:** 高壓輸出端子。
6. **RETURN端子:** 回線端子。
7. **校正按鍵開關:** 要進入校正模式時，需先按住此開關，再開啟輸入電源開關。
8. **保險絲座:** 輸入電源保險絲座，如需更換保險絲時，請更換正確規格的保險絲。
9. **輸入電源座:** 標準IEC 320電源插座，用以連接NEMA的標準電源線。
10. **接地端子:** 機殼接地端子。在本儀器操作運轉前，請務必將本接地安裝妥當。
11. **CURRENT端子:** 接地阻抗測試的電流輸出端子。
12. **SCANNER 輸出裝置:** 掃描器 1-8 點的高壓輸出端子和接地測試電流輸出端子，連接到DUT的測試點。

第四章 設定說明

SE開機後，畫面會停留在開機動畫，按任一鍵即進入主目錄參數設定模式(如下圖)。此時可以直接按顯示畫面選擇參數設定。



SE備有連結鎖定功能，要進入參數設定前，需先確認是否被鎖定。於Perform Tests畫面下，按Test鍵後，如果本儀器已被鎖定，會發出兩聲短暫"嗶"的警告聲，同時顯示器也會顯示，如下圖。請將1505安裝於SIGNAL INPUT。



4.1 系統參數(Setup System)設定

進入Setup System依序為時間及日期設定(Time and Date)、校正日期預警(Calibration Alert)、硬體功能設定(Hardware)、使用者介面設定(User Interface)及資訊(Information)。這些系統參數為測試時在儀器上的一般設定條件，與儀器測試的功能參數並無任何關聯，系統參數設定的儲存的位置，也與功能參數完全分開，如下圖。



4.1.1 時間和日期設定(Time and Data)

按下Time and Data後，直接點選需修改的日期或時間，使用數字鍵輸入正確的時間及日期。Set Date為選擇設定日期，Set Time為設定時間，Data Format為選擇設定年、月、日顯示方式：dd/mm/yyyy 或 mm/dd/yyyy 或 yyyy/mm/dd；Time Format為選擇設定24小時制或12小時制，如下圖。



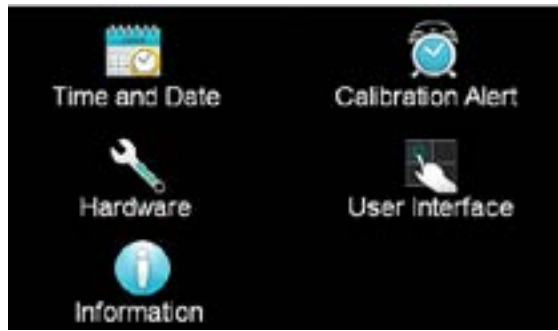
4.1.2 校正提示功能(Calibration Alert)

按下Calibration Alert後，直接點選需修改的日期，使用數字鍵輸入正確的日期。Calibration Alert設定是否預開啟預警顯示功能；Calibration Date為校正時間(無法修改時間)；Calibration Due為下次校正時間；Alert Date設定預警顯示日期。



4.1.3 硬體設定(Hardware)

按下Hardware後，可進行智能接地中斷功能(Smart GFI)、遠端控制(PLC Remote)、單一步驟測試(Single Step)、測試失敗停止(Fail Stop)、量測值(Measurement)、鮑率(Baudrate)、步驟連結不斷電(ProVOLT)、螢幕保護(Screensaver)、A/B測試(A/B Test)、螢幕更新(Reflash)、清除重置(Reset Clear)、ARC檢測頻率(ARC Frequency)、控制模式(Control mode)、條碼(Barcode)、測試結果設定(Result Data)、GPIB地址等參數設定，如下圖。



點選
Hardware



Smart GFI 0.0mA	PLC Remote OFF
Single Step OFF	Fail Stop ON
Measurement Average	Baudrate 9600

向上滑動



Control mode SE	Barcode
Result Data	

點選
Hardware



ProVOLT OFF	Screensaver OFF
A/B Test OFF	Reflash Step
Reset Clear ON	ARC Frequency 10k - 30k Hz

4.1.3.1 智能接地中斷功能(Smart GFI)

請用數字鍵輸入Smart GFI的偵測電流，設定範圍為 0.5-5.0mA。如Smart GFI設定為4mA，本分析儀對被測物進行測試時，如人體誤觸時...，其電流大於4mA時，本分析儀隨即告警並停止輸出。

4.1.3.2 遠端控制(PLC Remote)

請點選螢幕上的ON或OFF來選擇PLC遙控為開啟或關閉。如PLC遙控設定為ON，本分析儀的測試啟動功能必須經由儀器背板的遙控端子控制，面板上的TEST開關不會起作用，而RESET開關仍然維持可以操作不受任何影響；如PLC遙控設定為OFF，本分析儀的測試操作功能完全由面板上的TEST開關和RESET開關操作，但是背板上的遙控RESET仍然有效。

4.1.3.3 單步驟測試(Single Step)

請按面板功能鍵(Single Step)，按下後輸入選擇切換為ON或OFF。如Single Step設定為ON，本分析儀執行步驟連結測試時，當第一組Step測試結束時，需再按TEST開關，才會執行下一組Step測試，如Single Step遙控設定為OFF，本分析儀執行步驟連結測試時，當第一組Step測試結束時，會自動連結下一組Step測試。

4.1.3.4 測試失敗停止(Fail Stop)

請按面板功能鍵(Fail Stop)，按下後輸入選擇切換為ON或OFF。這個功能主要用於多個測試步驟被連接成為一個測試程序組合。假如測試失敗停止模式設定為ON，測試程序會在被測物測試失敗的步驟中停止繼續測試。如果尚有未完成的測試步驟，擬繼續完成測試，可以再按TEST開關，測試程序會往前繼續執行。如果先按RESET開關，然後再按TEST開關，測試程序會回到從第一個步驟，重新開始測試。如測試失敗停止模式設定為OFF，無論被測物在測試程序的步驟中是否失敗，本分析儀的程式會繼續往前測試，一直到整個測試程式完成為止。

4.1.3.1 智能接地中斷功能(Smart GFI)

請用數字鍵輸入Smart GFI的偵測電流，設定範圍為 0.5-5.0mA。如Smart GFI設定為4mA，本分析儀對被測物進行測試時，如人體誤觸時...，其電流大於4mA時，本分析儀隨即告警並停止輸出。

4.1.3.2 遠端控制(PLC Remote)

請點選螢幕上的ON或OFF來選擇PLC遙控為開啟或關閉。如PLC遙控設定為ON，本分析儀的測試啟動功能必須經由儀器背板的遙控端子控制，面板上的TEST開關不會起作用，而RESET開關仍然維持可以操作不受任何影響；如PLC遙控設定為OFF，本分析儀的測試操作功能完全由面板上的TEST開關和RESET開關操作，但是背板上的遙控RESET仍然有效。

4.1.3.3 單一步驟測試(Single Step)

請按面板功能鍵(Single Step)，按下後輸入選擇切換為ON或OFF。如Single Step設定為ON，本分析儀執行步驟連結測試時，當第一組Step測試結束時，需再按TEST開關，才會執行下一組Step測試，如Single Step遙控設定為OFF，本分析儀執行步驟連結測試時，當第一組Step測試結束時，會自動連結下一組Step測試。

4.1.3.4 測試失敗停止(Fail Stop)

請按面板功能鍵(Fail Stop)，按下後輸入選擇切換為ON或OFF。這個功能主要用於多個測試步驟被連接成為一個測試程序組合。假如測試失敗停止模式設定為ON，測試程序會在被測物測試失敗的步驟中停止繼續測試。如果尚有未完成的測試步驟，擬繼續完成測試，可以再按TEST開關，測試程序會往前繼續執行。如果先按RESET開關，然後再按TEST開關，測試程序會回到從第一個步驟，重新開始測試。如測試失敗停止模式設定為OFF，無論被測物在測試程序的步驟中是否失敗，本分析儀的程式會繼續往前測試，一直到整個測試程式完成為止。

4.1.3.5 量測值(Measurement)

可設定量測值為平均值(Average)或有效值(True RMS)。
備註：若測試參數要與7400系列相同，請切換為平均值(Average)。

4.1.3.6 鮑率(Baudrate)

可設定RS232的傳輸速度，分別為9600、19200、38400。
備註：傳輸速度設定越快會為會有干擾問題。

4.1.3.7 步驟連結不斷電(ProVOLT)

在相同測試參數下，步驟連結時測試電壓不會下降到0V。如ProVOLT設定為ON，當測試步驟1的電壓大於或小於測試步驟2的電壓，測試步驟1的電壓會直接上昇或下降到測試步驟2的電壓；如ProVOLT設定為OFF，當測試步驟1測完後，電壓會降到0V再爬昇到試步驟2的設定電壓。

備註：若直流耐壓測試步驟1的電壓大於測試步驟2的電壓時，輸出會降到0V。

4.1.3.8 保護(Screensaver)

請點選螢幕上的ON或OFF來選擇螢幕保護程式為開啟或關閉。如設定為ON，當儀器超過30 分鐘沒有做任何動作，畫面會自動進入螢幕保護程式；如設定為OFF，則為關閉此功能。當進入螢幕保護程式後，按任何按鍵的第一個動作都是喚醒螢幕，喚醒後，各按鍵才回復各自的功能，指令也是相同的動作。

備註：由於螢幕在同一個畫面停留太久會有殘影現象，當殘影現象發生後，表示LCD已有受損。因此，建議將此功能開啟，以延長LCD螢幕壽命。

4.1.3.9 A/B測試(A/B Test) – 選購

請點選螢幕上的ON或OFF來選擇螢幕保護程式為開啟或關閉。如設定為ON，儀器需要搭配掃描通道使用，以8通道為例，1- 4 通道為A組、5 – 8 通道為B組；當A組在進行測試時，B組可進行裝卸的動作，A組測完後可直接進行B組的測試，此時可替換A組的待測物。如設定為OFF，則為關閉此功能。

4.1.3.10 螢幕更新(Reflash)

選項為 STEP(步驟)/LAST(最後)，預設值為 STEP，當設定為STEP 時，畫面每100ms更新一次；設LAST 時，測試完最後一個測試步驟後，先送PLC 訊號，再做畫面更新。

4.1.3.11 清除重置(ReSet Clear)

選項為 ON/OFF，預設值為 ON。當設定為 ON 時，在測試出現 Fail 要先按 ReSet 鍵才能按 TEST 鍵繼續測試；在設定為 OFF 時，測試出現 Fail 直接按 TEST 能繼續測試。以上功能不論Fail Stop 設定為 ON 或 OFF 動作都一樣。

4.1.3.12 ARC檢測頻率(ARC Frequency)

可設定ARC 量測的頻寬為10k – 30kHz 或 10k – 150kHz，機器預設為10k - 30kHz。

備註：ARC測試雖非法規的必要測項，為提升產品品質，用戶可針對自身產品的電器元件特性設定其偵測靈敏度。標準的檢測頻寬為 10K - 30KHz。因應電子元件微小化以及新興高頻寬元件的應用，SE可以將檢測頻率擴展到10K - 150KHz*。

* 惟須注意提高ARC偵測的靈敏度 or 更改到頻寬較寬的偵測，皆可能影響產品檢出的良率。

4.1.3.13 控制模式(Control mode)

進入後可設定 SE、7400。若設定 7400，儀器的系統參數，測試參數與相關指令都會變成 7400 的設定格式。

備註：當選擇7400 後，其面板的USB, Barcode與多國語言等功能即無法使用。

4.1.3.14 條碼(Barcode)

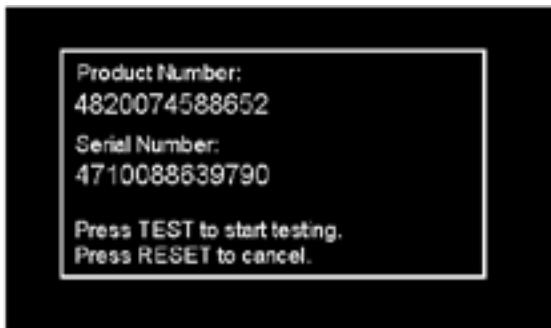
進入後可設定Barcode I/P與Autostart，Barcode I/P可設定OFF, SERIAL, PROD CHEK/SER, PROD/SER1/SER2, PROD/SER, PROD one/SER and PRODUCT。若設定OFF，為關閉此功能；若設定SER/PROD，需要掃描SERIAL Number與PRODUCT Number才能執行測試；若設定SERIAL#，則需掃描SERIAL Number才能執行測試；若設定PRODUCT#，則需掃描PRODUCT Number才能執行測試。

- OFF：關閉此功能
- SERIAL：掃描產品序號後才能執行測試
- PROD CHEK/SER：掃描產品碼與產品序號後，需要再掃描一次產品碼，確認產品碼無誤後才會執行測試
- PROD/SER1/SER2：掃描產品碼與2組產品序號後才能執行測試
- PROD/SER：掃描產品碼與產品序號後才能執行測試
- PROD one/SER：若為同一批產品，第一次需要掃描產品碼與產品序號，在第二次測試時，只要掃描產品序號就可以執行測試，系統會自動記憶產品碼
- PRODUCT：掃描產品碼後才能執行測試

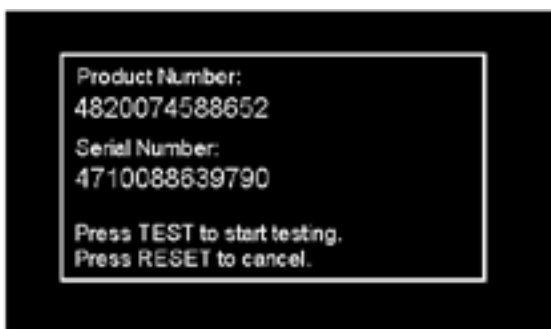
當Autostart設定為ON時，在條碼掃描完成後即自動執行測試；若設定OFF，為關閉此功能，即在條碼掃描完成後需要按TEST鍵執行測試。顯示如下：



Barcode I/P設定為PROD/SER，掃描顯示如下：



Barcode I/P設定為SERIAL#，掃描顯示如下：



Barcode I/P設定為PRODUCT#,掃描顯示如下:



當掃描完後,按TEST可進行測試,或按RESET可終止測試。若當掃描的條碼輸入錯誤時,可以按RESET鍵清除後重新掃描。

備註:條碼掃描器的連接線請與高壓線(H.V.)分開,避免造成干擾等問題。

4.1.3.15 測試結果設定(Result Data)

Location int. memory	Test Result ALL
Results Limit 000000	Time Limit 00 Days

存取位置(Location)

設定測試結果的儲存位置,可選擇int. memory或USB disk。當選擇int. memory時,測試結果會存在儀器內部的記憶體空間;當選擇USB disk時,測試結果會直接存在外部的USB 硬碟。

顯示測試結果(Test Result)

測試結果會自動儲存在內部的記憶體裡,可以設定None、Fail、Pass或All,當設定None時,不會儲存任何結果在記憶體裡;當設定 Fail 時,只會儲存測試結果為Fail的項目;當設定 Pass 時,只會儲存測試結果為Pass的項目;當設定ALL時,會儲存所有的測試結果,包含Pass、Fail或測試中暫停的狀況。

測試結果儲存上限(Results Limit)

此限制設定允許使用者設定內建記憶體可儲存的測試結果資料筆數,設定值由 0~1 至 100,000,出廠設定為 "0", "0"時即表示關閉此功能。當所儲存的資料數超過設定值時,顯示器會出現一個警告訊息提醒使用者可儲存資料數已滿。

儲存時間上限(Time Limit)

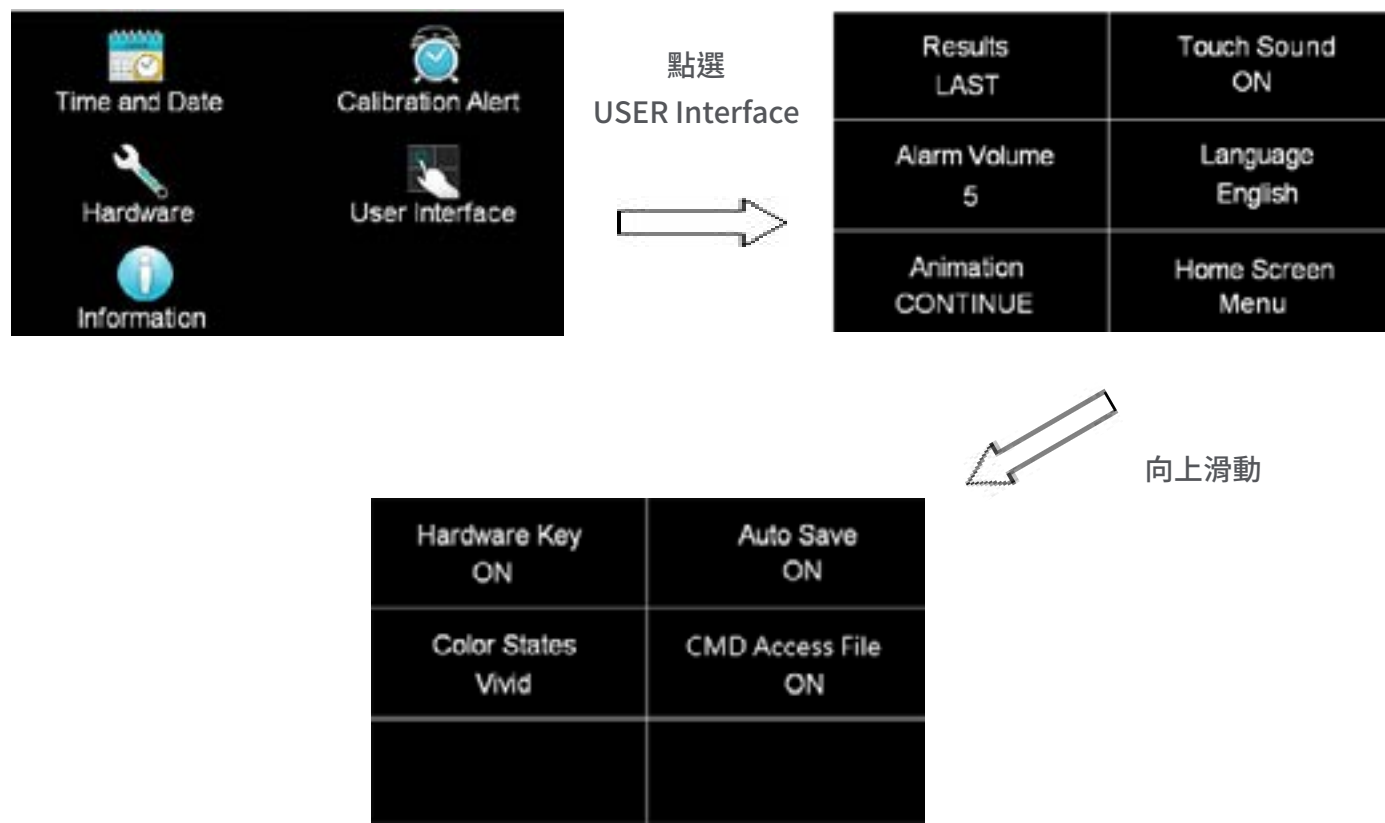
此限制設定允許使用者設定內建記憶體中所儲存的資料可保存的天數,設定值由 0~1 至 99,出廠設定為 "0", "0"時即表示關閉此功能。當任何一個所儲存的測試資料已保存的時間超過設定值時,顯示器會出現一個警告訊息提醒使用者儲存時間已超過

4.1.3.16 GPIB地址設定(選購OPT.109)

如本儀器未安裝GPIB介面卡,程式不會出現這個設定模式,不會顯示這個選項。請用數字鍵輸入GPIB的位址0-30,然後再按ENTER鍵,顯示器會立即出現設定的位址數字。在GPIB位址設定完成後,程式會自動將所設定的GPIB位址的數字存入記憶程式內。

4.1.4 使用者介面(User Interface)

按下User Interface鍵後，可進行測試結果(Result)、按鍵音效(Touch Sound)、警報音量(Alarm Volume)、語言設定(Language)、開機畫面(Animation)、開機顯示畫面(Home Screen)、硬體按鍵(Hardware Key)、自動存檔(Auto Save)、測試結果顏色設定(Color States)等參數設定。



4.1.4.1 測試結果(Result)

此功能是設定測試結果的顯示狀態，可設定ALL、LAST、P/F三種模式。

選擇ALL模式

當執行單一測試或有設定步驟連結時，測試結束後會顯示"所有"執行的測試結果，顯示畫面如下：

001 ACW PASS 5.00KV 0.001mA 10.0s 0.000mAR	002 IR PASS 500V >50.00GΩ 5.0s

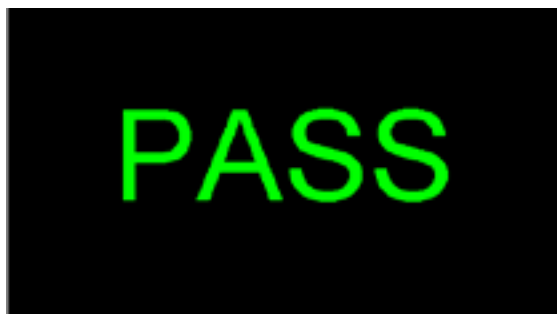
選擇LAST模式

當執行單一測試或有設定步驟連結時，測試結束後會顯示"最後一組"執行的測試結果，下圖是執行設定AC 5.00KV通過測試(Pass)顯示畫面：



選擇P/F模式

當執行單一測試或有設定步驟連結時，測試結束後會顯示"PASS"或"FAIL"執行的測試結果。當執行Connect Step測試時只要有其中一組Step測試時判定失敗，測試結束後畫面會顯示"FAIL"，若全部的測試步驟都通過測試畫面會顯示"PASS"。顯示畫面如下：



4.1.4.2 按鍵音效(Touch Sound)

可以設定觸碰螢幕的欄位或按鍵時是否需要音效提醒。若設定為ON時，當觸碰欄位或按鍵會有音效效果；若設定為OFF則為關閉此功能。

4.1.4.3 警報音量(Alarm Volume)

0是作為關閉警報聲音之用，1的音量最小，而9為最大。請用數字鍵輸入警報音量的數字，按下ENTER鍵，程式會立即改變警報音量的設定，並發出設定之音量。在警報音量設定完成後，時程式會自動將所設定的警報音量數字存入記憶程式內。

4.1.4.4 語言設定(Language)

本儀器提供英文、繁體中文、簡體中文、日文做選擇。

4.1.4.5 開機畫面(Animation)

若設定CONTINUE時，當開機動畫結束時直接跳至MENU畫面；若設定PAUSE時，當開機動畫結束時需按任意鍵跳至MENU畫面。

4.1.4.6 開機顯示畫面(Home Screen)

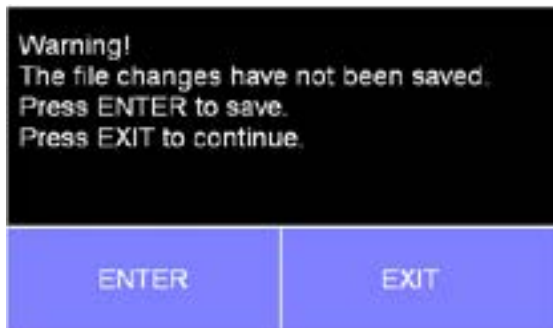
若設定Perform Tests時，開機動畫結束後直接顯示Perform Tests畫面；若設定Menu時，開機動畫結束後直接顯示Menu畫面；若設定My Menu時，開機動畫結束後直接顯示設定My Menu畫面。

4.1.4.7 硬體按鍵(Hardware Key)

此功能適用於在測試中需要戴手套的操作人員。若設定為ON時，當儀器在待機畫面，可以按My Menu鍵進入；當儀器在輸出過程中，可以透過面板的硬體按鍵My Menu/Select鍵與▶鍵來調整電壓，My Menu/Select鍵為遞增鍵，▶鍵為遞減鍵；若設定為OFF為關閉此功能。

4.1.4.8 自動存檔(Auto Save)

當變更測試參數(Setup Tests)的設定且離開設定畫面時，畫面會彈出一個視窗詢問是否要存檔。若設定為ON時，離開設定畫面儀器會自動將變更的參數直接儲存，不會詢問；若設定為OFF為關閉此功能，即為每次變更參數離開編輯畫面時，都會出現詢問視窗，如下圖。



4.1.4.9 測試結果顏色設定(Color States)

測試結果顯示畫面可以設定顏色，增加辨識的功能。舉例如下：

若設定為Dull，顯示如下：

PASS



FAIL



若設定為Dull，顯示如下：

PASS

FAIL



4.1.4.10 從指令存檔 (CMD Access File)

更改參數時可以選擇是否保存到快取記憶體。如果您的應用是軟體控制，建議此參數設置為 OFF，可以擴展ROM的使用週期。

4.1.5 資訊(Information)

顯示公司訊息與儀器之型號、序號、軟體版本等相關資訊

4.1.6 導入/導出系統參數與測試參數

SE有導入(Import)和導出(Export)系統和測試參數的功能，此功能可以將系統參數或測試參數所編輯好的數據導出在USB硬碟中，目的是可以將設定好的資料儲存起來或是導入到其他本系列產品的儀器上。要使用此功能需要先插入兼容的USB硬碟在前面板Data上，在主選單中選擇系統參數後，畫面會增加Import與Export兩個圖示如下。



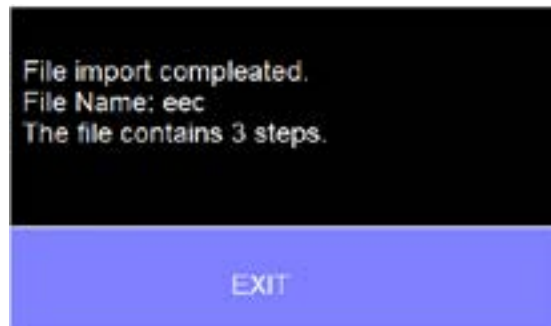
若選擇導入(Import)時，畫面顯示如下：

Import System	Import One File
Import System and All Files	Import A files

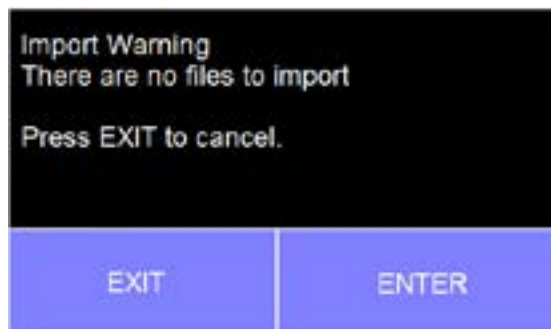
這裡會有四種不同導入的選項，當項目選擇完成後，會直接將USB硬碟中的資料匯出在儀器的記憶體。

- 系統(System)– 導入系統檔案(Import System file)
- 單筆檔案(One File)– 導入單筆測試檔案(Import a single Test file)
- 系統與全部檔案(System and All Files)– 導入系統參數與所有測試檔案(Import System and all Test files)
- 全部檔案(All Files)– 導入所有測試檔案(Import all Test files)

例如，如果要導入單筆測試資料的話，請選擇單筆測試檔案(Import a single Test file)，儀器會讀取USB 硬碟所有資料，之後再選擇需要導入的檔案，面板將會顯示導入的進度，完成後，顯示畫面如下：



如果沒有USB硬碟沒有相對應的資料，顯示錯誤訊息如下：



如果測試檔案的名稱已經存在在儀器內部記憶體的話，顯示錯誤訊息如下：



若選擇導出(Export)時，會有四種不同導出的選項，畫面顯示如下。當項目選擇完成後，會直接將測試檔案存入USB硬碟中。

Export System	Export One File
Export System and All Files	Export A Files

- 系統(System)– 導出系統檔案(Export System file)
- 單筆檔案(One File)– 導出單筆測試檔案(Export a single Test file)
- 系統與全部檔案(System and All Files)– 導出系統參數與所有測試檔案(Export System and all Test files)
- 全部檔案(All Files)–導出所有測試檔案(Export all Test files)

舉例說明：

如果要導出單筆測試資料的話，請選擇單筆測試檔案(Export a single Test file)後再輸入檔案名稱，儀器會將選擇的項目存入 USB 硬碟中，面板將會顯示導入的進度，完成後，顯示畫面如下：



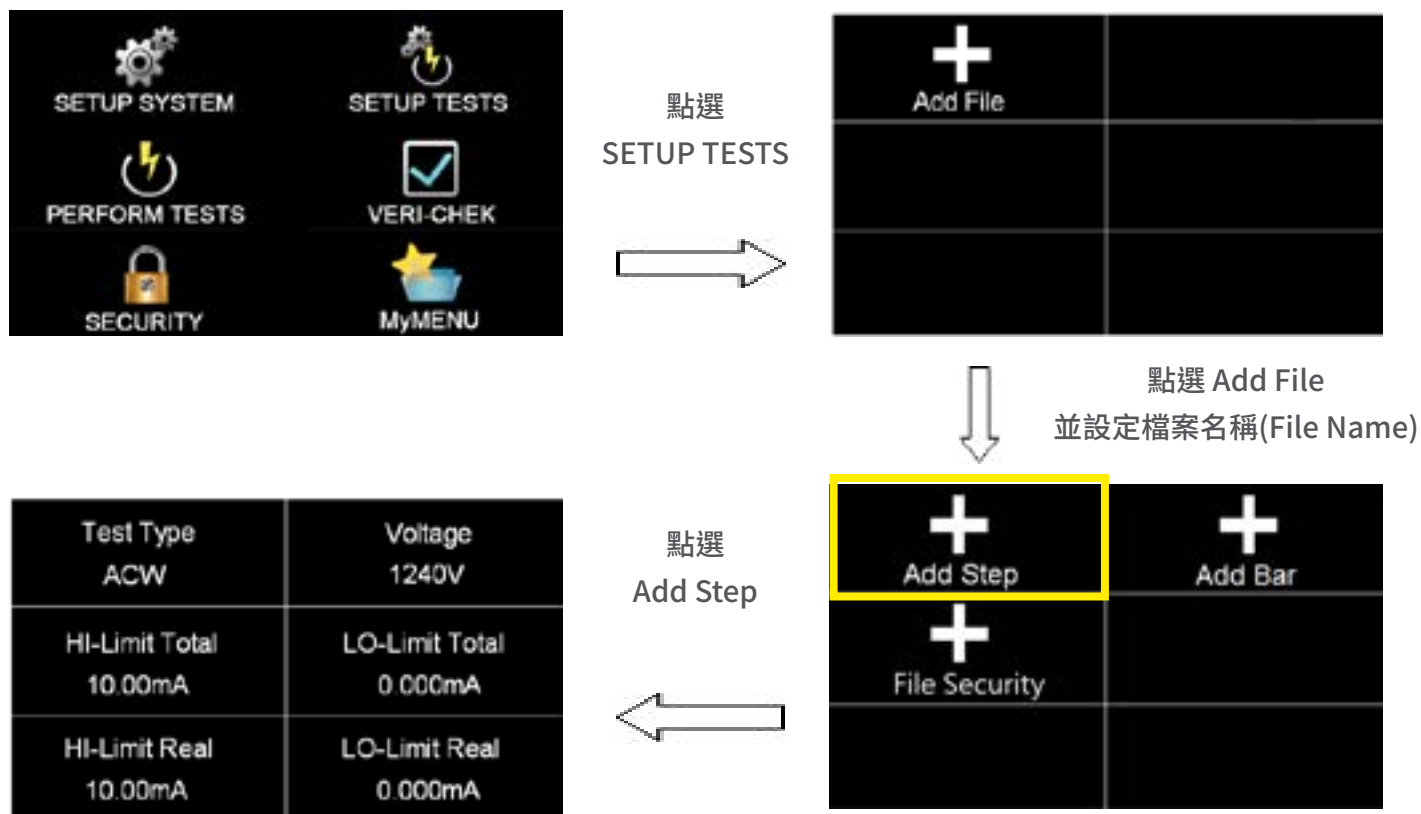
如果測試檔案的名稱已經存在在儀器內部記憶體的話，會顯示錯誤訊息如下：



4.2 測試參數(Setup Tests)設定

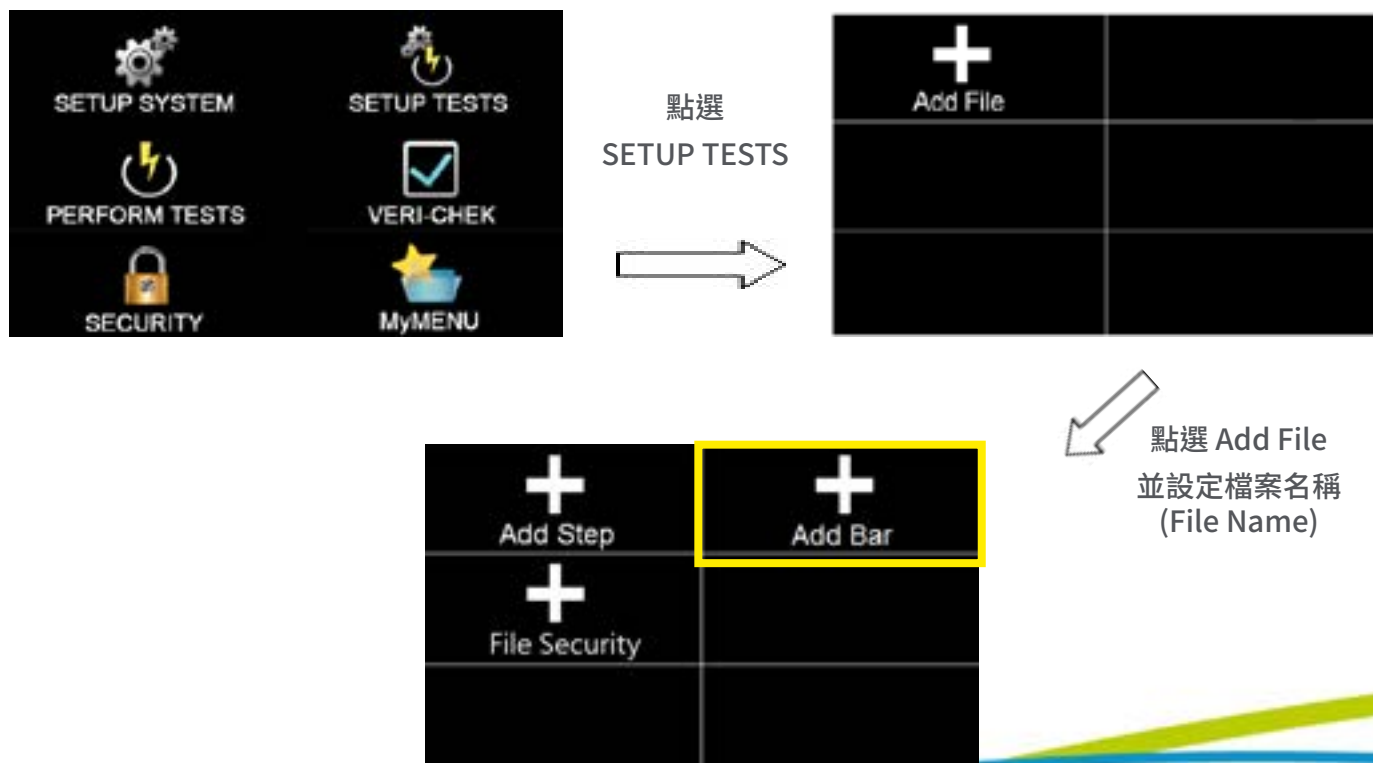
Add Step

若第一次進入Setup Tests內沒有測試檔案，請點選 Add File增加測試檔案，需設定檔案名稱，之後再點選 Add Step 設定測試參數，顯示如下圖。



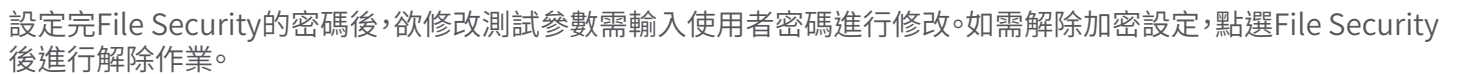
Add Step

若第一次進入Setup Tests內沒有測試檔案，請點選 Add File增加測試檔案，需設定檔案名稱，之後再點選 Add Step 設定測試參數，顯示如下圖。

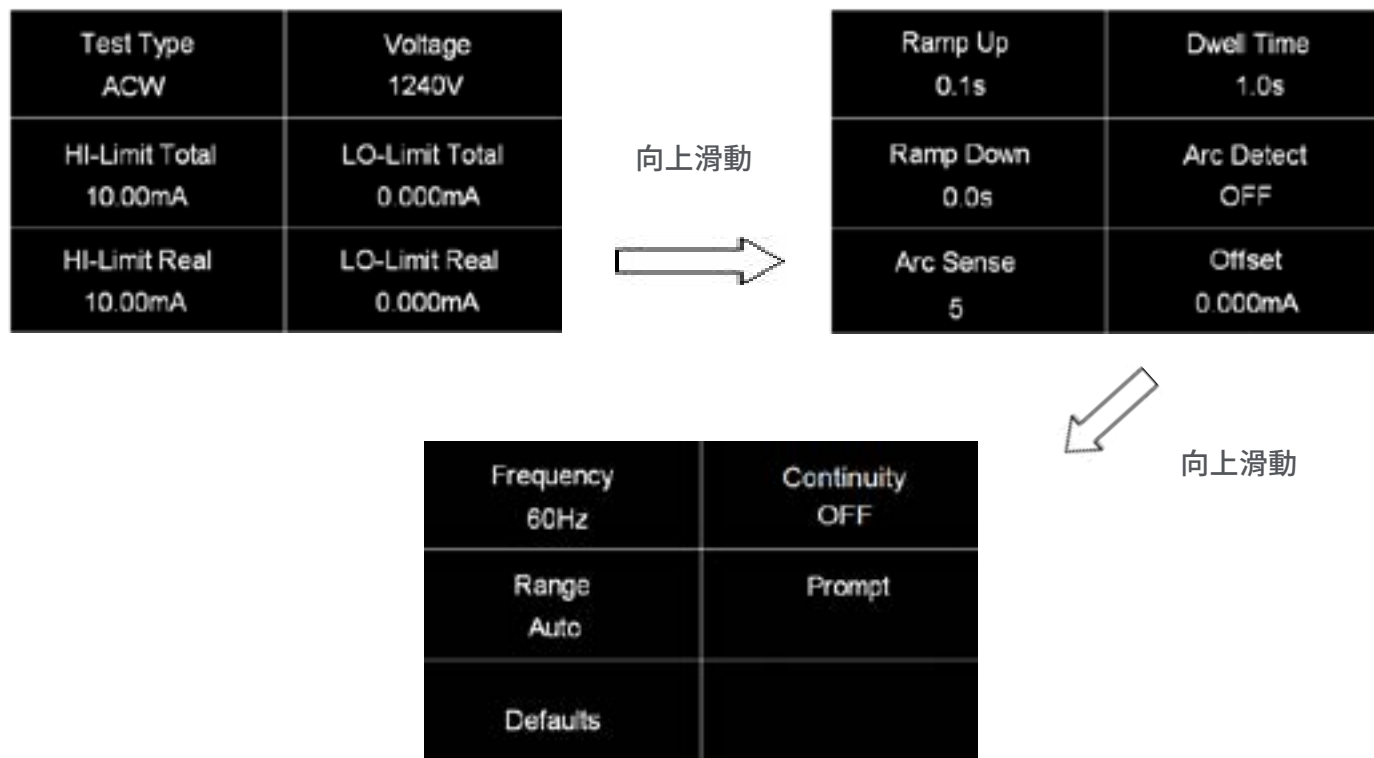


1. 此參數最多可以設定20個位元
2. Add Bar 參數有設定時，此測試檔案的測試步驟最多只能設定 199

使用者檔案加密，避免多個使用者進行儀器操作修改到他人的設定值，可以透過使用者加密功能，建立專屬的測試檔案。



4.2.1 交流耐壓(AC Withstand)



項目	說明	單位
Voltage	輸出電壓設定	V
HI-Limit Total	總漏電電流上限設定	mA
LO-Limit Total	總漏電電流下限設定	mA
HI-Limit Real	真實漏電電流上限設定	mA
LO-Limit Real	真實漏電電流下限設定	mA
Ramp Up	緩升時間設定	s
Dwell Time	測試時間設定	s
Ramp Down	緩降時間設定	s
Arc Detect	電弧偵測判定模式	
Arc Sense	電弧靈敏度設定	
Offset	漏電電流歸零設定。請直接按Test鍵讓本分析儀自動量測測線及治具的漏電電流值並做歸零動作，此時必須先將被測物的測試線取下；按數字鍵0可做清除用。	mA
Frequency	輸出頻率設定	Hz
Continuity	設定輸出高壓之前，確認地線與外殼是否導通。(選購)	
Range	設定電流檔位為自動換檔或固定檔位。若設定AUTO，儀器會自動選擇適合的電流檔位；若設定Fixed，需要在總漏電電流上限(HI-Limit Total)設定一個值決定該電流檔位，其目的可以縮短測試時間。	
Prompt	設定提示功能	
Scanner	矩陣式掃描器設定(選購)	
Defaults	回復為出廠設定值	

4.2.2 直流耐壓(DC Withstand)

Test Type DCW	Voltage 1200V
Output Polarity +	HI-Limit 10000uA
LO-Limit 0.0uA	Ramp Up 0.3s

向上滑動



Dwell Time 1.0s	Ramp Down 0.0s
Charge-Lo 0.0uA	Arc Detect OFF
Arc Sense 5	Offset 0.0uA



向上滑動

Ramp-HI 0.0uA	Continuity OFF
Range Auto	Low Range OFF
Prompt	Defaults

項目	說明	單位
Voltage	輸出電壓設定	V
Output Polarity	輸出極性設定 (選購)	
HI-Limit	漏電電流上限設定	uA
LO-Limit	漏電電流下限設定	uA
Ramp Up	緩升時間設定	s
Dwell Time	測試時間設定	s
Ramp Down	緩降時間設定 緩降時間設定0秒時,儀器測試完後,會去監控待測物的殘留電壓,當電壓下降至 60V後才能進行下一個測試,此時畫面會顯示Discharge無法再進行其他測試,以確保操作者的安全。	s
Charge Lo	最低充電電流設定。最低充電電流設定,是應用於偵測測試線或測試治具的連接是否正常,以確保測試結果的正確性。由於直流耐壓測試時漏電電流通常都非常小,所以很難以漏電電流的下限值作為判定測試線或測試治具的連接是否正常的依據。然而被測物實際上都具有些許電容性(Capacitive)存在,因此可以利用偵測被測物的充電電流,作為檢測測試線或測試治具的連接是否正常的依據。 手動設定最低充電電流數值,請用數字鍵輸入最低充電電流數值,然後再按ENTER鍵存入最低充電電流的數值。 自動設定最低充電電流數值,請先將儀器和被測物與測試線或治具接好,並且確定所設定的輸出電壓和緩升時間參數,與將來實際要做測試的數據完全一致。如果使用掃描器,則掃描器的通道亦需依實際狀況設定,才能按TEST開關。本分析儀會依據每一記憶組內的每一個測試步驟中所設定的電壓,對每一個測試步驟分別做最低充電電流設定,並且分別存入所設定的數值。在按TEST開關後,本分析儀會自動讀取被測物的充電電流,並將充電電流值大約設定在讀取值的1/2。	uA

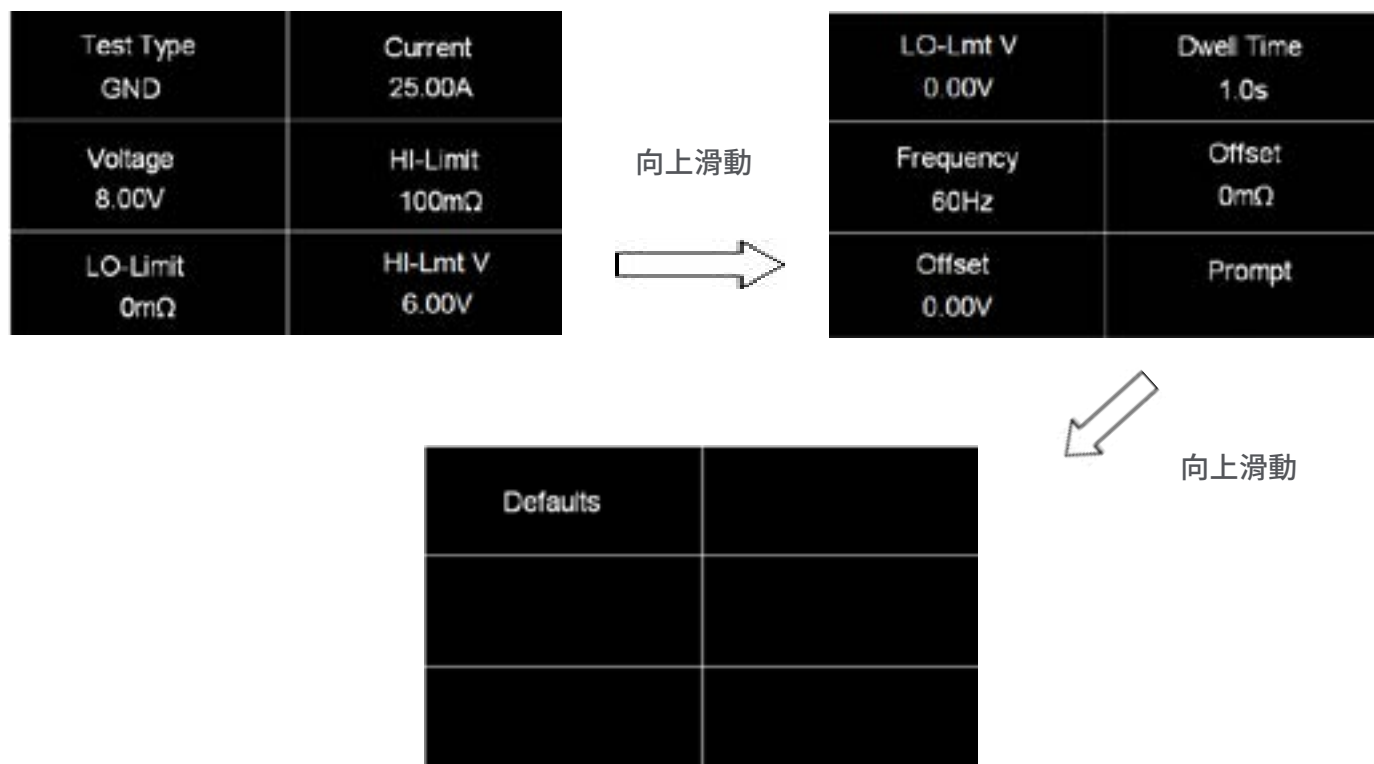
Arc Detect	電弧偵測判定模式	
Arc Sense	電弧靈敏度設定	
Offset	漏電電流歸零設定。請直接按Test鍵讓本分析儀自動量測測線及治具的漏電電流值並做歸零動作，此時必須先將被測物的測試線取下；按數字鍵0可做清除用。	uA
Ramp-HI	緩衝電流功能只針對在緩升時間中的充電電流做判定而已。其功能主要是為了避免因在直流耐壓測試進行時，某些被測物的充電電流值常常會高於漏電電流上限的設定值，而引起誤判，進而影響到漏電電流上限判定的正確性。	uA
Continuity	設定輸出高壓之前，確認地線與外殼是否導通。(選購)	
Range	設定電流檔位為自動換檔或固定檔位。若設定AUTO，儀器會自動選擇適合的電流檔位；若設定Fixed，需要在總漏電電流上限(HI-Limit)設定一個值決定該電流檔位，其目的可以縮短測試時間。	
Low Range	電流低解析設定。當設定為ON時，電流最小解析度為0.0001uA；當設定為OFF時，電流最小解析度為0.1uA。	
Prompt	設定提示功能	
Scanner	矩陣式掃描器設定 (選購)	
Defaults	回復為出廠設定值	

4.2.3 絕緣阻抗(Insulation Resistance)



項目	說明	單位
Voltage	輸出電壓設定	V
Output Polarity	輸出極性設定 (選購)	
HI-Limit	絕緣阻抗上限設定	MΩ
LO-Limit	絕緣阻抗下限設定	MΩ
Ramp Up	緩升時間設定	s
Delay Time	判定延遲時間設定。主要功能為執行絕緣阻抗上、下限判定的時間依據，因為被測物大多數都具有電容性(Capacitive)而產生很大的充電電流，判定延遲時間可以讓本分析儀在充電電流穩定之後，才做判定。判定延遲的時間必須依據被測物的電容性大小和絕緣阻抗所需要的精確度。	s
Dwell Time	測試時間設定	s
Ramp Down	緩降時間設定	s
Charge Lo	最低充電電流設定。最低充電電流設定，是應用於偵測測試線或測試治具的連接是否正常，以確保測試結果的正確性。由於直流耐壓測試時漏電電流通常都非常小，所以很難以漏電電流的下限值作為判定測試線或測試治具的連接是否正常的依據。然而被測物實際上都具有些許電容性(Capacitive)存在，因此可以利用偵測被測物的充電電流，作為檢測測試線或測試治具的連接是否正常的依據。 手動設定最低充電電流數值，請用數字鍵輸入最低充電電流數值，然後再按ENTER鍵存入最低充電電流的數值。 自動設定最低充電電流數值，請先將儀器和被測物與測試線或治具接好，並且確定所設定的輸出電壓和緩升時間參數，與將來實際要做測試的數據完全一致。如果使用掃描器，則掃描器的通道亦需依實際狀況設定，才能按TEST開關。本分析儀會依據每一記憶組內的每一個測試步驟中所設定的電壓，對每一個測試步驟分別做最低充電電流設定，並且分別存入所設定的數值。在按TEST開關後，本分析儀會自動讀取被測物的充電電流，並將充電電流值大約設定在讀取值的1/2。	uA
Range	設定電流檔位為自動換檔或固定檔位。若設定AUTO，儀器會自動選擇適合的電流檔位；若設定Fixed，需要在總漏電電流上限(HI-Limit)設定一個值決定該電流檔位，其目的可以縮短測試時間。	
Prompt	設定提示功能	
Scanner	矩陣式掃描器設定(選購)	
Defaults	回復為出廠設定值	

4.2.4 接地阻抗(Ground Bond)



項目	說明	單位
Current	輸出電流設定	A
Voltage	輸出電壓設定 備註：輸出電壓設定主要在限制輸出開路的最大電壓，也就是設定在定電壓模式下的輸出電壓，而量測接地阻抗時為定電流模式，為確保滿足定電流模式下的所有量程規格，輸出電壓請設定在8V。	V
HI-Limit	阻抗上限設定	mΩ
LO-Limit	阻抗下限設定	mΩ
HI-Lmt V	電壓上限設定	V
LO-Lmt V	電壓下限設定	V
Dwell Time	測試時間設定	s
Frequency	輸出頻率設定	Hz
Offset	測試線歸零設定。 手動設定，請用數字鍵輸入數值，再按ENTER鍵存入測試線歸零的數值。測試線歸零設定範圍為0-200 mΩ (1 mΩ / step)。 自動設定，先將測試導線、治具和被測物上的電源線或連接線(如果電源線或連接線要一起OFFSET)串聯接成一個回路，並將回路的兩端分別接到機器的CURRENT和RETURN的端子上，然後再按面板上的"TEST"開關，程式會按照液晶顯示器上記憶程式組內輸出電流的設定，自動輸出一個記憶程式組所設定輸出電流值，並且自動量測電路上的電阻值。	mΩ
Offset		V
Prompt	設定提示功能	
Scanner	矩陣式掃描器設定(選購)	
Defaults	回復為出廠設定值	

4.2.5 接地導通(Continuity)(選購OPT.7002)



項目	說明	單位
HI-Limit	阻抗上限設定	Ω
LO-Limit	阻抗下限設定	Ω
Dwell Time	測試時間設定	s
Offset	測試線歸零設定。 手動設定，請用數字鍵輸入數值，再按ENTER鍵存入測試線歸零的數值。測試線歸零設定範圍為0-10.00 (1 /step)。 自動設定，先將測試導線、治具和被測物上的電源線或連接線(如果電源線或連接線要一起OFFSET)串聯接成一個回路，並將回路的兩端分別接到機器的CURRENT和RETURN的端子上，然後再按面板上的"TEST"開關，程式會按照液晶顯示器上記憶程式組內輸出電流的設定，自動輸出一個記憶程式組所設定輸出電流值，並且自動量測電路上的電阻值。	Ω
Prompt	設定提示功能	
Defaults	回復為出廠設定值	

4.2.6 編輯測試步驟

若要進行測試步驟編輯，如下圖，請按住003的測試步驟，畫面上方會顯示複製(Copy)、貼上(Paste)、插入(Insert)、刪除(Delete)等選項做編輯。



先點選欲複製的測試步驟再按複製(Copy)，待此測試步驟反白後點選欲貼上的位置再按貼上(Paste)即可。

複製(Copy)與貼上(Paste)的操作步驟

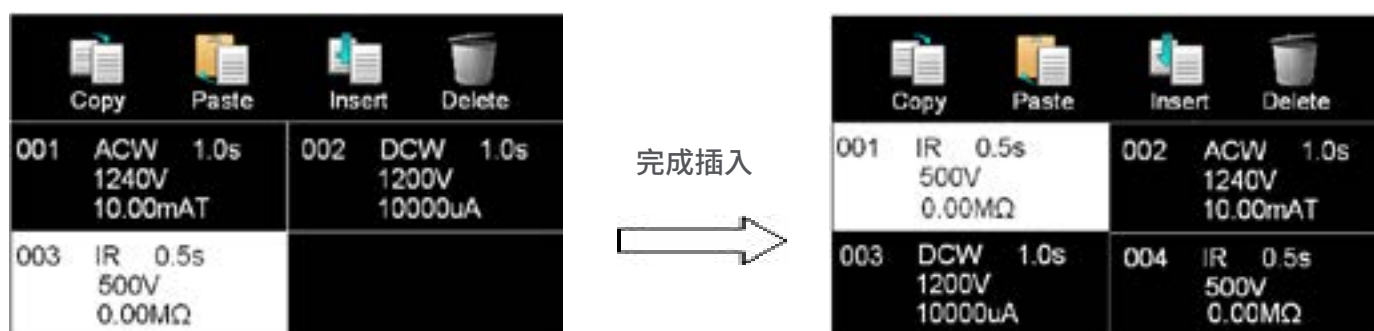
若要複製一個已設定的測試項到新的欄位，如下圖，先點選003測試步驟當此測試步驟反白後再點選複製(Copy)，之後點選空白欄位後再點選貼上(Paste)即可完成。



備註：若貼上的位置不是點選在空白欄位，而是在已有測試步驟的地方，則該測試步驟會被覆蓋掉。如複製003測試步驟，但選擇001的測試步驟點選貼上，則原來的001 ACW會變成IR。

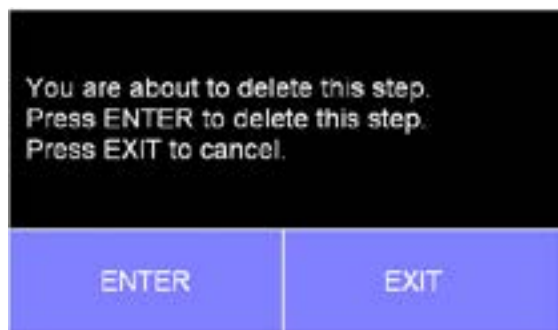
插入(Insert)的操作步驟

若要在001的位置插入一個IR的測試項，先點選003測試步驟當此測試步驟反白後再點選複製(Copy)，之後點選001的測試步驟後再點選插入(Insert)即可完成。



刪除(Delete)

點選欲刪除的測試步驟，當此選項反白後再點選刪除(Delete)，系統會再做一次詢問，若按確認即可刪除。



4.2.7 編輯測試檔案

若要進行測試檔案編輯，如下圖，在畫面上按住003 TEST 的測試檔案，畫面上方即會顯示存檔(Save)、另存新檔(Save As)、重新命名(Rename)、刪除(Delete)等選項做編輯



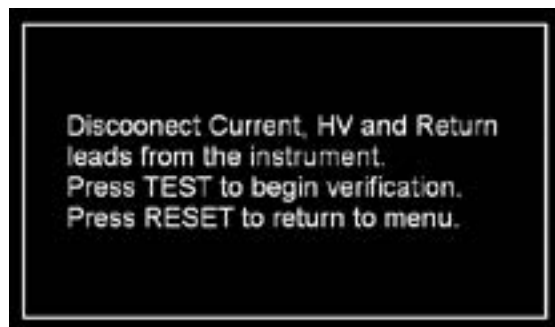
4.3 自我檢測功能(FAIL-CHEK)

進入自我檢測功能，畫面顯示如下：



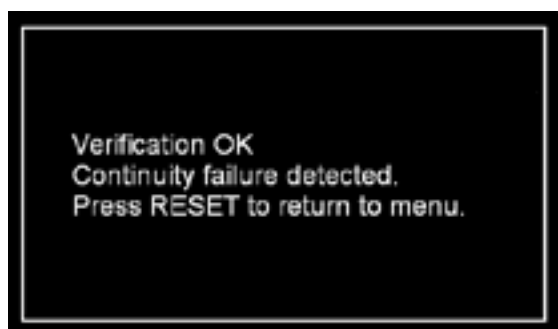
4.3.1 接地導通(Continuity) (選購)

若有選購Continuity功能，按面板功能鍵選擇Continuity，顯示訊息如下：



移除Current、H.V.、Return連接線。按TEST鍵開始測試；按RESET回到Verification目錄。

測試合格顯示如下：

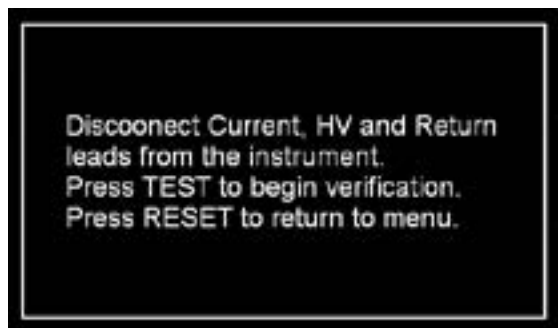


測試失敗顯示如下：



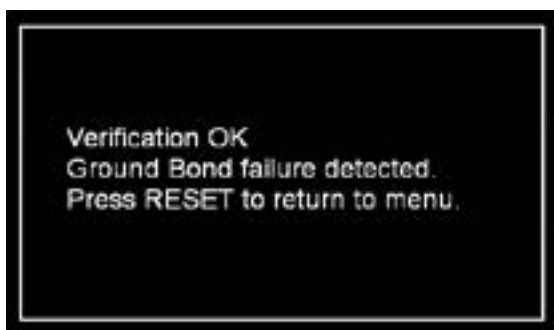
4.3.2 接地阻抗(Ground Bond)

點選Ground Bond，顯示訊息如下：



移除Current、H.V.、Return連接線。按TEST鍵開始測試；按RESET回到Verification目錄。

測試合格顯示如下：

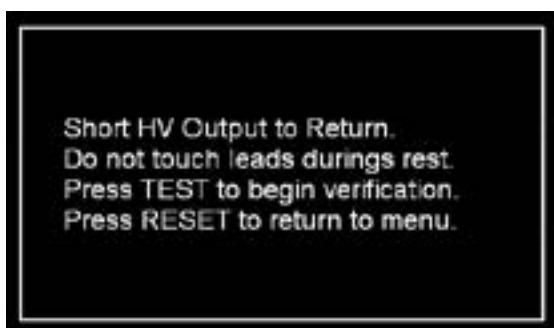


測試失敗顯示如下：



4.3.3 交流耐壓(AC Hipot)

按面板功能鍵選擇AC Hipot，顯示訊息如下：

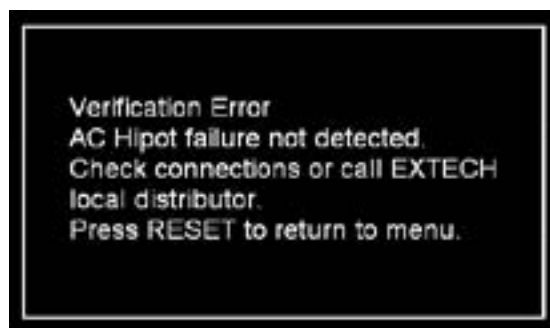


將H.V.、Return連接線短路，並於測試過程中請勿觸碰測試線。按TEST鍵開始測試；按RESET回到Verification目錄。

測試合格顯示如下：

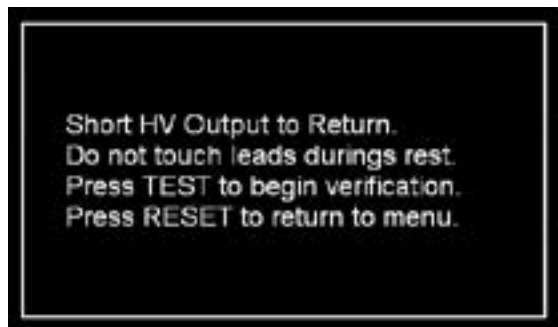


測試失敗顯示如下：



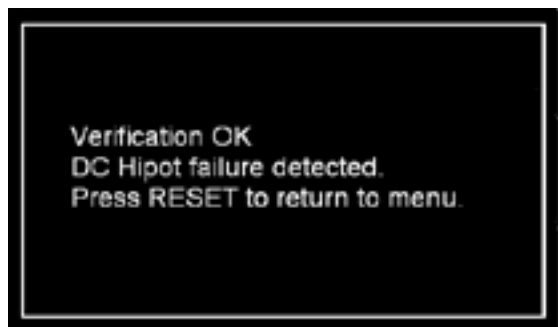
4.3.4 直流耐壓(DC Hipot)

按面板功能鍵選擇AC Hipot，顯示訊息如下：



將H.V.、Return連接線短路，並於測試過程中請勿觸碰測試線。按TEST鍵開始測試；按RESET回到Verification目錄。

測試合格顯示如下：

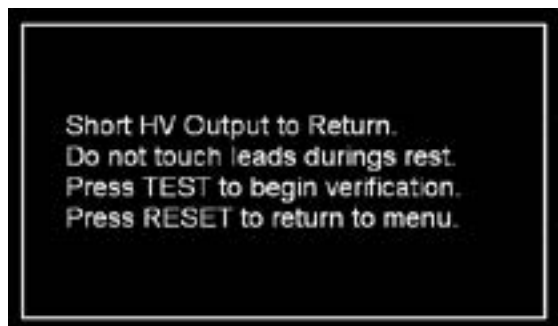


測試失敗顯示如下：



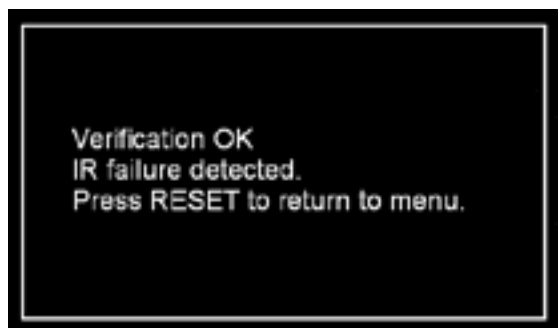
4.3.5 絕緣阻抗(IR)

按面板功能鍵選擇IR，顯示訊息如下：



將H.V.、Return連接線短路，並於測試過程中請勿觸碰測試線。按TEST鍵開始測試；按RESET回到Verification目錄。

測試合格顯示如下：



測試失敗顯示如下：

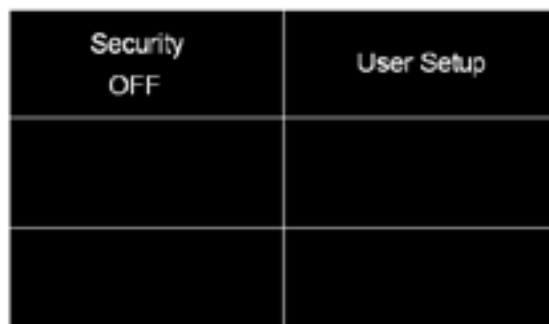
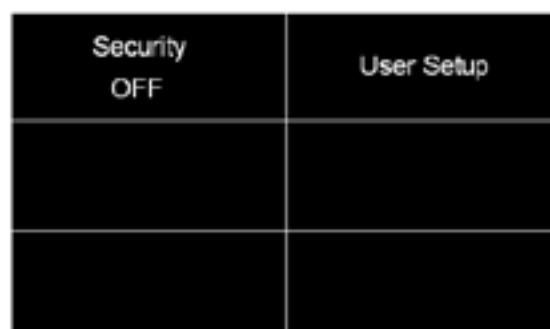


4.4 安全設定(Security)

進入使用者權限設定，因首次使用尚未被設定其他使用者名稱，故請先按User Setup進行設定，畫面顯示如下：



點選
SECURITY



點選 User Setup

4.4.1 增加使用者(Add User)

進入Add User增加使用者，即可編輯帳號(User ID)、密碼(Password)、確認密碼(Confirm Password)，長度為8個字元、安全等級設定(Security Level)。

本儀器系統的安全等級設定區分為四個等級：

- 僅能測試(Run Only)：只能執行測試。
- 載入參數(Recall Setups)：可呼叫測試檔案與執行測試。
- 參數編輯(Edit Setups)：可編輯參數、呼叫測試檔案與執行測試。
- 全系統功能(Full System)：可執行系統所有的功能。

4.4.2 編輯使用者(Edit User)

若要變更使用者權限或密碼時，只要進入新增使用者(Add User)的畫面後再點選欲變更的使用者名稱即可。

4.4.3 刪除使用者(Delere User)

若要刪除沒有在使用的ID，在進入新增使用者(Add User)的畫面後按住欲刪除的ID就可以進入刪除畫面，之後再點選Delete即可。

備註：系統已內置一個ADMIN的管理者身份，此ID無法刪除。

將使用者權限設定好後，回到Security的第一層畫面，將Security設定為ON，即可執行此功能，如下圖。

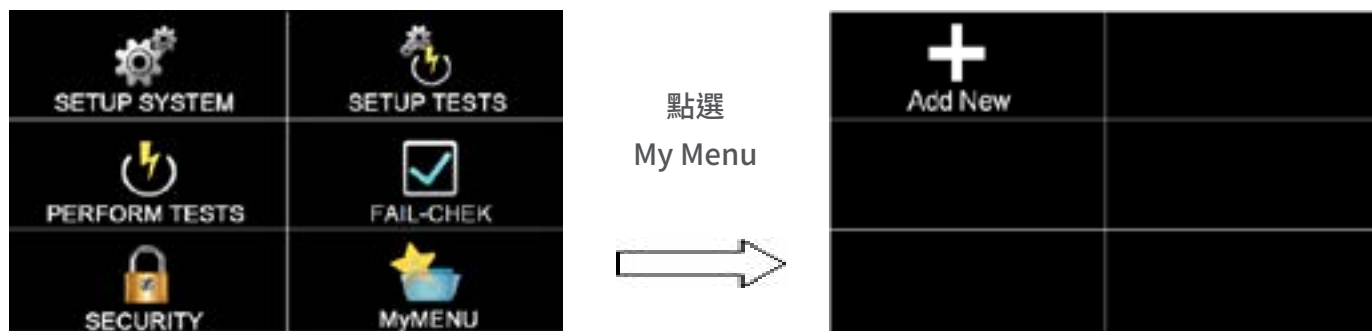


若按Logout登出後，以Run Only 的身份登入，畫面顯示如下：



4.5 我的最愛(My Menu)

按面板功能鍵My menu，顯示畫面如下：



當首次進入My Menu，畫面只有一個新增(Add New)的選項。

如要進行編輯我的最愛(My Menu)，只要在欲設定的畫面底下，按住觸控螢幕右下角My Menu的硬體按鍵約3秒，儀器會發出嗶一聲表示已設定完成。

編輯

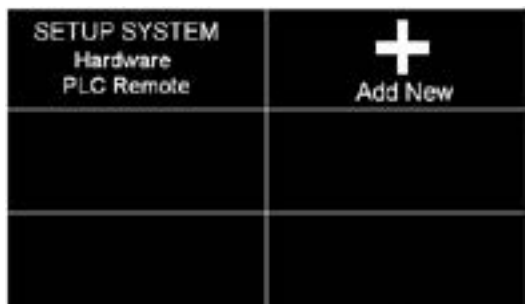
若要將遠端控制(PLC Remote)設定在我的最愛(My Menu)中，請先進入到下圖畫面。



1. 按觸控螢幕右下角My Menu，



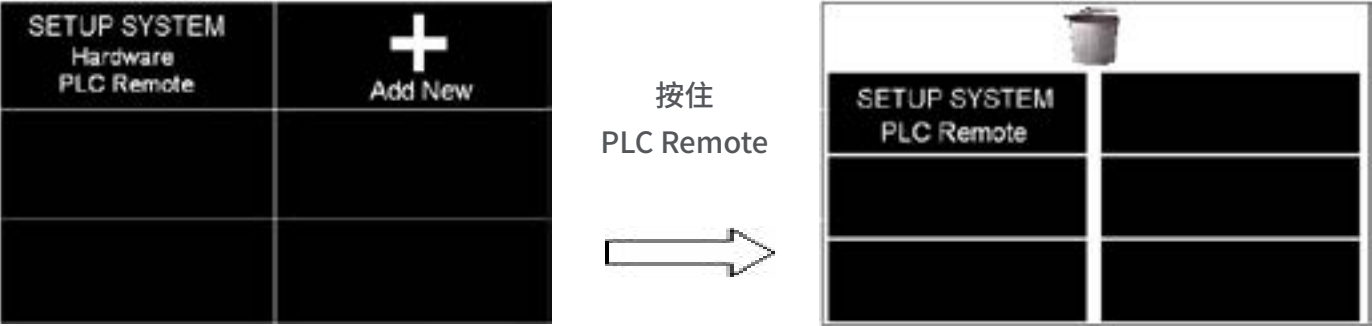
2. 當儀器會發出嗶一聲後再進入My Menu畫面，顯示如下：



備註：My Menu只有六組快捷鍵供使用，若 My Menu 已經設定六個快捷鍵後，即無法再作設定，需把不用的參數移除後才能繼續設定。

刪除

如下圖，若要將PLC Remote從My Menu中移除，按住PLC Remote後會變成小圖形、之後再移動到垃圾桶上即可刪除。






第五章 操作說明

5.1 執行測試(Perform Tests)設定

執行測試Perform Tests為測試項目的操作鍵，顯示畫面如下：



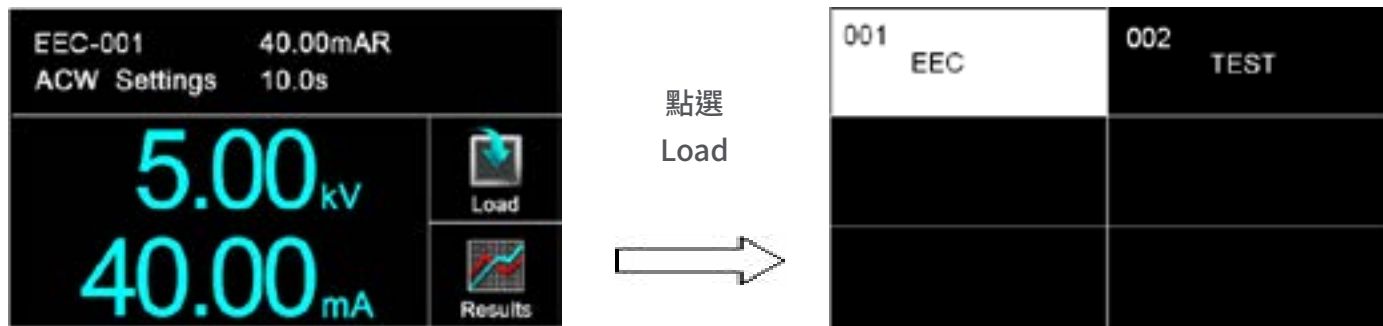
5.1.1 畫面說明

編號	項目	說明
1	FILE000-001	檔案名稱
2	ACW	目前所選擇的測試模式
3	Settings	狀態列
4	40.00mAR	真實漏電流
5	10.0s	測試時間
6	SCANNER	點矩陣掃描設定狀態(選購SCANNER模組才会有此畫面)
7	Load	讀取檔案
8	Results	測試結果
9	5.00KV	測試電壓
10	40.00mA	總漏電流
11		回上一頁快捷鍵
12		回主頁快捷鍵
13		執行測試快捷鍵

5.1.2 設定說明

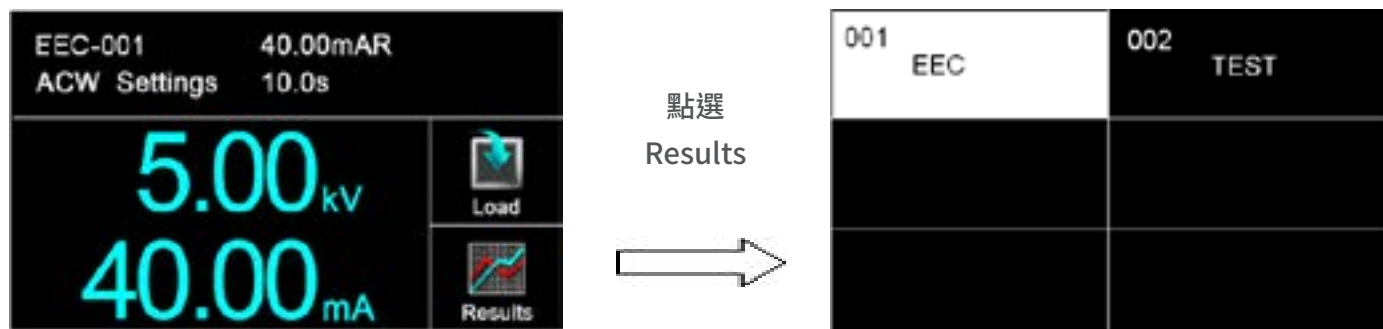
5.1.2.1 讀取檔案(Load)

SE的記憶組最大可達200組，其測試程式記憶組(File)與測試步驟(STEP)可依使用者自行配置，系統會自動連結下一個測試步驟。但每個測試步驟只能設定一種測試功能。點選LOAD，執行程式會叫出該測試程式記憶組內所儲存的設定參數，並回到待測的模式，準備依照所叫出的測試參數執行測試，如下圖。



5.1.2.2 測試結果(Results)

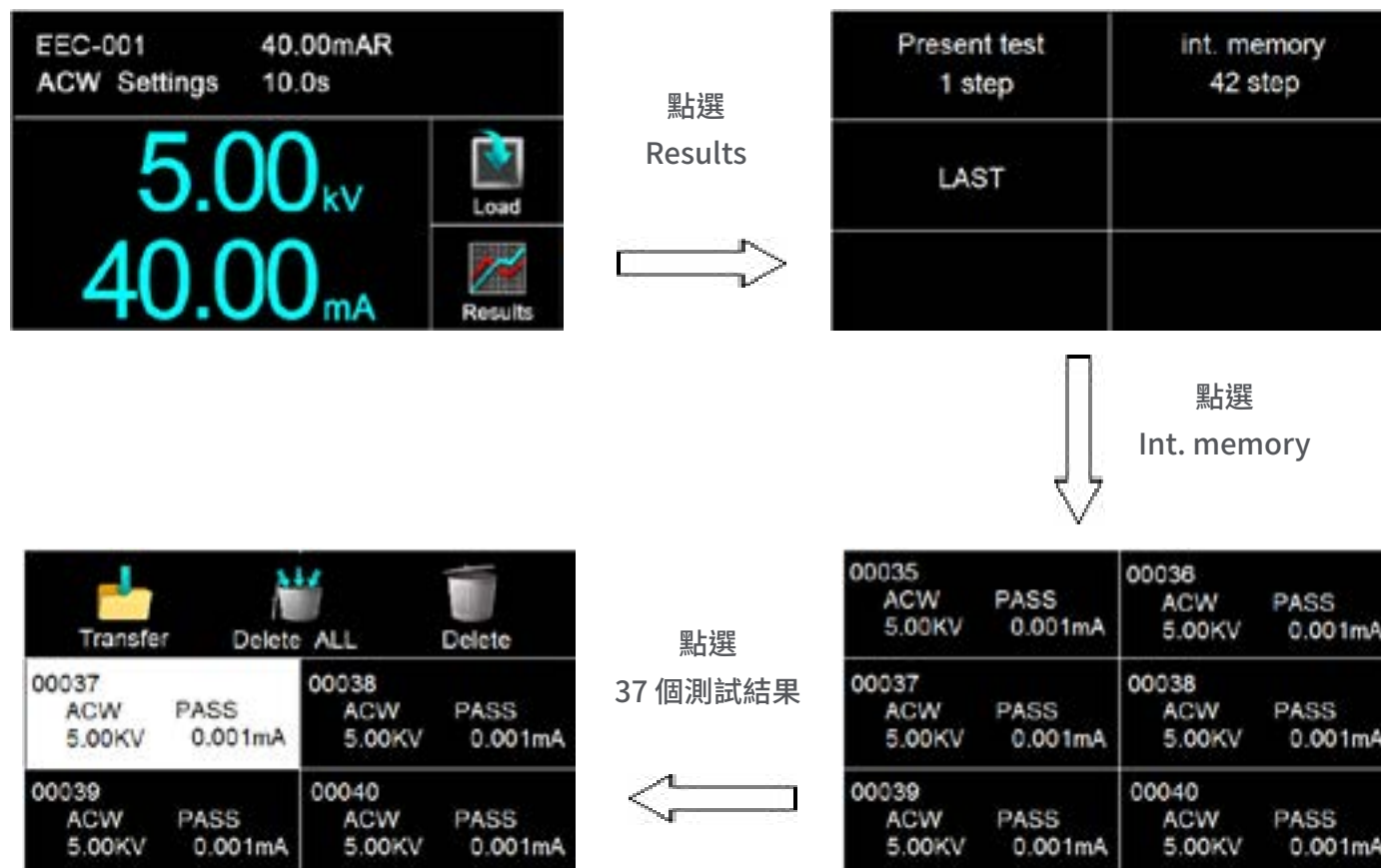
按面板功能鍵(Results)後可選擇查看測試結果(Present test)、內部記憶體(Int. memory)、最後測試步驟(LAST)。若選擇Present test時，可以查看當下測試的結果，可以點選任一個測試步驟去看細部的資料；若選擇 Int. memory時，可以查看以往的測試紀錄；若選擇LAST時，它只會儲存最後一個測試步驟，並且不會因為重新開機造成資料被重置。



備註：需執行測試後，此鍵才有作用

5.1.2.3 編輯內部記憶體資料

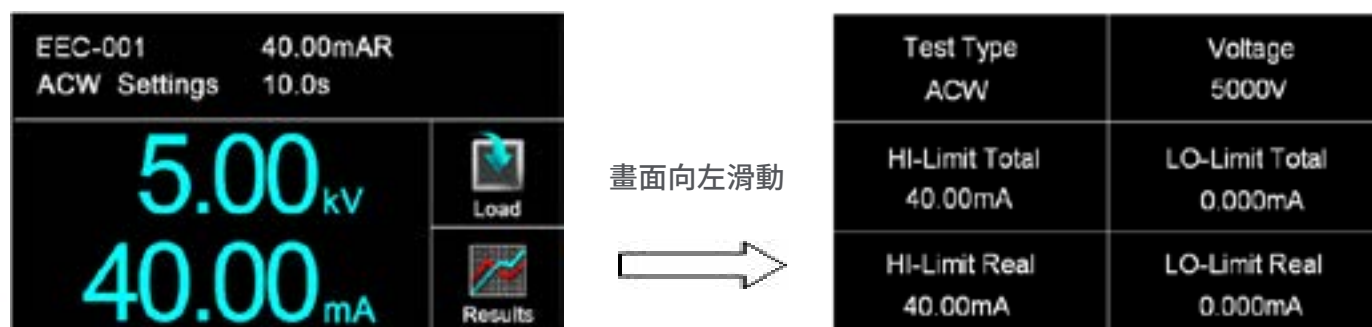
內部記憶體(Int. memory)的儲存空間為 100,000筆資料，若要進行編輯的話，請於待測畫面點選 Results Int. memory 按住00037的欄位約 3 秒，畫面上方會顯示轉移(Transfer)、全部刪除>Delete ALL)、刪除>Delete)功能鍵，請參考底下操作步驟。



功能鍵	說明
轉移(Transfer)	可以將內部記憶體的測試結果轉存到USB 硬碟。
全部刪除>Delete ALL)	清除內部記憶體所有測試結果。
刪除>Delete)	刪除單筆測試結果。

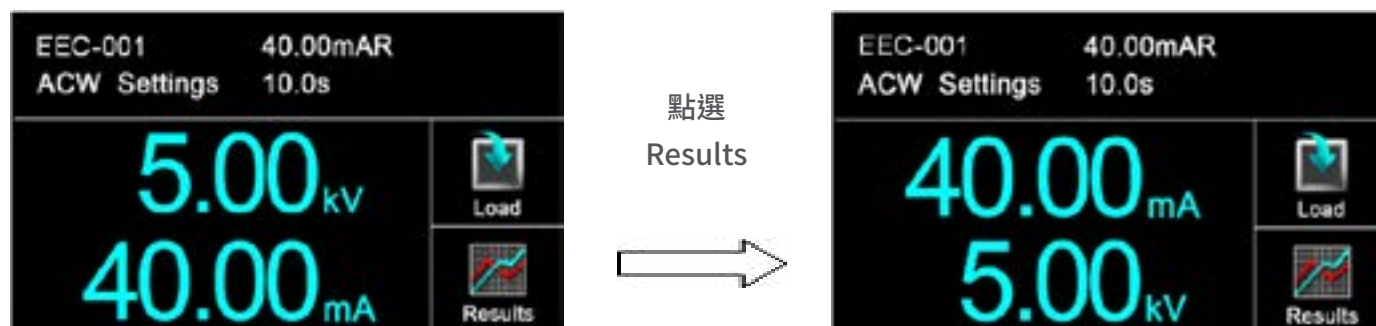
5.1.2.4 快速變更設定

在執行測試(Perform Tests)畫面時，可將螢幕向左滑動去變更該測試項的測試參數；若上下滑動則可查看其他測試步驟的設定狀態；若有需要變更，也可以透過畫面向左滑動去變更測試參數。



5.1.2.5 變更顯示視窗位置設定

如下圖，當按住5.00KV的位置後，5.00KV會變成小圖形，此時可移動此圖形到相對應的位置，若拉到40.00mA的位置放開，則電壓與總漏電流的位置互換，可依使用者習慣做設定。

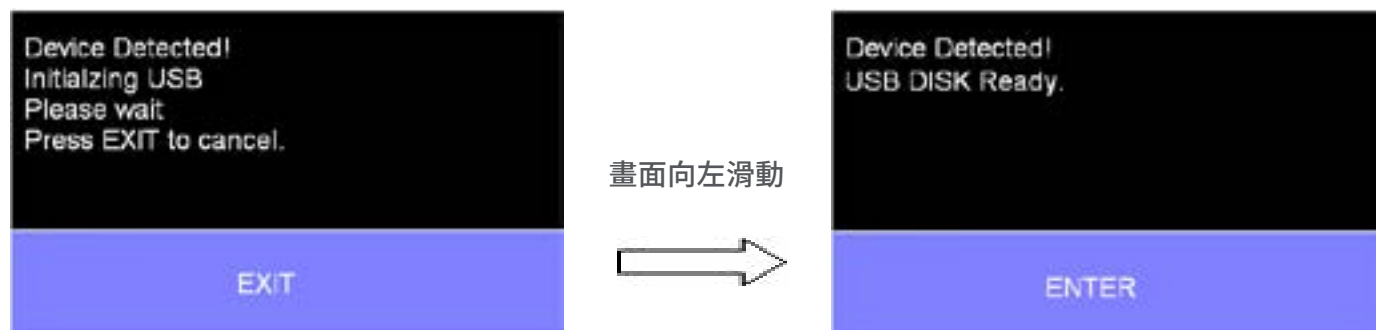


各測試模式可以調整位置的參數如下：

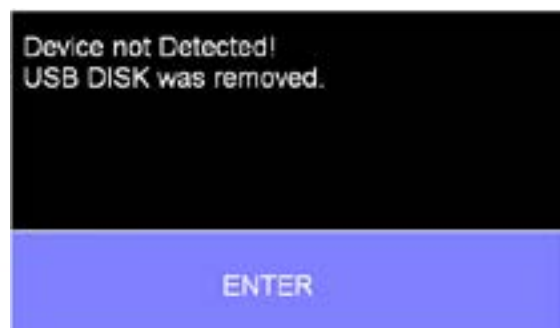
功能鍵	說明
交流耐壓	測試電壓、總漏電流、真實漏電流、測試時間
直流耐壓	測試電壓、漏電流、測試時間
絕緣阻抗	測試電壓、阻抗、測試時間
接地阻抗	測試電流、阻抗、測試時間
接地線檢測	阻抗、測試時間

5.1.2.6 USB DISK

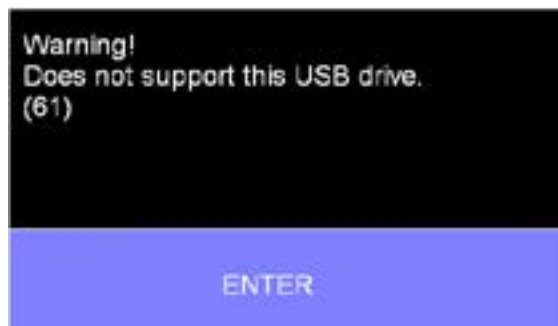
當 USB DISK與儀器連接後會自動偵測，如下圖：



若將USB Disk從儀器上移除，顯示訊息如下：



若畫面顯示如下：，請先將USB DISK與電腦連接進行格式化動作，其格式需選擇FAT 16 或 FAT 32。



5.2 訊息說明

以下為本儀器在執行測試時，會出現在液晶顯示器上的各種訊息。

測試時間(Dwell)

在測試進行時，在本分析儀讀到第一筆測試結果之前，測試的結果會不斷的被更新，此時液晶顯示器會顯示Dwell。

延遲時間(Delay)

在測試剛開始時，測試電壓正逐步上升的期間之中，此時本分析儀尚未讀到第一筆測試結果，LCD顯示器會顯示Delay。

緩升測試(Ramp Up)

假如測試設定有緩升(Ramp Up)測試程序，在本分析儀讀到第一筆測試結果之前，測試的結果會不斷的被更新，此時液晶顯示器會顯示Ramp Up。

緩降測試(Ramp Down)

假如測試設定有緩降(Ramp DN)測試程序，在本分析儀讀到第一筆測試結果之前，測試的結果會不斷的被更新，此時液晶顯示器會顯示Ramp Down。

測試通過(Pass)

假如被測物在做測試時的整個過程都沒有任何異常的現象發生時，被認定為通過測試，LCD顯示器會顯示Pass。

測試中止(Abort)

假如測試正在進行之中，而按"RESET"開關或使用遙控裝置中斷測試，LCD顯示器會顯示Abort。

上限測試失敗(HI-LIMIT)

如被測物在做測試時超過該測試上限設定值，會被程式判定為上限造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示HI-Limit。

下限測試失敗(LO-LIMIT)

如被測物在做測試時的該測試低於下限設定值，會被程式判定為下限造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示LO-Limit。

總漏電電流上限測試失敗(HI LIMIT T)

如被測物在做交流耐壓測試時的漏電電流量超過總漏電電流上限設定值，會被程式判定為漏電電流上限造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示HI-Lmt T。

總漏電電流下限測試失敗(LO LIMIT T)

如被測物在做交流耐壓測試時的漏電電流量低於總漏電電流下限設定值，會被程式判定為漏電電流下限造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示LO-Lmt T。

真實漏電電流上限測試失敗(HI LIMIT R)

如被測物在做交流耐壓測試時的漏電電流量超過真實漏電電流上限設定值，會被程式判定為漏電電流上限造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示HI-Lmt R。

真實漏電電流下限測試失敗(LO LIMIT R)

如被測物在做交流耐壓測試時的漏電電流量低於真實漏電電流下限設定值，會被程式判定為漏電電流下限造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示LO-Lmt R。

接地線檢測測試失敗(CONT-Fail)

如果在做交/直流耐壓測試時接地線檢測功能設為"ON"，如果接地線檢測測試失敗，LCD顯示器會顯示CONT-Fail。

電弧測試失敗(Arc Fail)

如被測物在做交流耐壓、直流耐壓測試時的漏電電流量在設定的漏電電流上限值以內，但是電弧的電流量超過電弧電流的設定值，造成的測試失敗，會被程式判定為被測物的電弧造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示Arc Fail。

短路(Short)

如被測物在做測試時，漏電電流量遠超過本分析儀可以量測的範圍之外，再加上本分析儀特殊的短路判定電路動作，會被程式判定為短路造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示Short。

充電電流測試失敗(Charge LO)

如果在做緩昇時洩漏電流低於充電電流設定值時，會被程式判定為充電電流造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示Charge LO。

耐壓崩潰(Breakdown)

如被測物在做測試時的漏電電流量遠超過本分析儀可以量測的範圍，並且電弧的電流量也遠超過本分析儀所能夠量測的正常數值之外，會被程式判定為耐壓崩潰造成的測試失敗，LCD顯示器會顯示Breakdown。

接地中斷失效(GND Fault)

如被測物在做測試時，人體誤觸高壓時，會被本分析儀程式判定為接地中斷失效(Smart G.F.I.)造成的停止測試，LCD顯示器會顯示GND Fault。

5.2.1 錯誤訊息顯示

Fatal Error 9002訊息

若顯示器出現"Fatal Error 9002"訊息，則表示系統參數的EEPROM發生錯誤。此時請先關閉本儀器電源再按"RESET"開機暫時解除該狀況，然後按"RESET"進入設定，再任意更改一系統參數之設定後儲存即可。

Fatal Error 9003訊息

若顯示器出現"Fatal Error 9003"訊息，則表示校正資料有誤。此時請先關閉本儀器電源再按"RESET"開機暫時解除該狀況，然後依校正方式隨意校正任一檔位即可。

Fatal Error 9004訊息

若顯示器出現"Fatal Error 9004"訊息，則表示儀器內部通訊有誤。此時請先關閉本儀器電源再按"RESET"開機暫時解除該狀況。

以上如儀器重新啟動後故障狀況沒有改善，請儘速和華儀電子的客支部或經銷商連絡。

5.2.2 USB 錯誤代碼

錯誤代碼	說明
USB device error.(9)	讀取 Barcode 錯誤
USB device error.(10)	開啟檔案錯誤
USB device error.(11)	讀取檔案錯誤
USB device error.(12)	檔案寫入錯誤
USB device error.(13)	檔案讀取錯誤
USB device error.(14)	檔案寫入內容錯誤
USB device error.(15)	檔案關閉錯誤 File closed error
USB device error.(16)	讀取檔案大小錯誤
USB device error.(17)	讀取 USB disk 錯誤
USB device error.(18)	讀取DISK剩餘容量錯誤
USB device error.(19)	讀取DISK格式錯誤
USB device error.(20)	指定讀取字元位置錯誤
USB device error.(21)	重新命名檔案名稱錯誤
USB device error.(22)	DATA孔插入無法辨識的DISK，或是BARCODE孔插入無法辨識的BARCODE
USB device error.(23)	搜尋SE檔案時發生錯誤
USB device error.(24)	刪除檔案時發生錯誤
USB device error.(26)	DISK格式不支援，只支援FAT16及FAT32二種
Does not support this USB device.(61)	當讀取STEP時，讀取到不正常的碼
EE ERROR	當判斷總STEP數量小於0，出現的字樣(變數計算時有用扣的，防止程式撰寫錯誤)
MEMORY ERROR	程式有不正常運作(例如：變數代入陣列，但變數超過陣列的大小)

5.3 操作程序及步驟

SE主要是設計供生產線自動化以及品質分析和檢驗使用，其操作和設定都非常簡便。不合理的設定和操作會給予兩聲短暫的警告，同時退回原來設定的狀態。請依照下列程序和步驟操作本分析儀。

1. 本分析儀為自動偵測輸入電源的電壓，不需切換輸入電壓之開關，在電源線的插頭接到市電電源以前，請先檢查保險絲的規格是否正確。然後再將地線接到本分析儀背板上的接地端子上。
2. 請將輸入電源線分別接到本分析儀和電源插座上，但是不要先將測試線接到本分析儀的輸出端子上。
3. 先將被測物或其測試治具端的測試線全部接受，然後再將回路線(Return)接到本分析儀的回路端子上，被測物接地線測試的測試線接到本分析儀的端子上，最後才將高壓測試線接到本分析儀的高壓端子上，並檢查所有的測試線是否全部接受。
4. 然後開啟本分析儀的輸入電源開關，然後程式會自動出現本分析儀最後一次測試時的記憶組和測試參數資料，並進入待測和參數設定模式。
5. 請先參考測試參數設定的說明，將本分析儀的一般測試參數，依序為時間及日期設定(Time and Data)、校正日期預警(Calibration Alert)、硬體功能設定(Hardware)、安全設定(Security)、使用者介面設定(User Interface)。這些儀器的系統參數為測試時在儀器上的一般設定條件，與儀器測試的功能參數並無任何關聯，這些系統參數設定的儲存的位置，也與功能參數完全分開。
6. 如果要重新設定測試參數，請按SetupTest鍵，進行參數設定模式，重新設定測試參數，詳細的設定方式、程序和步驟，請參考測試參數設定的說明。
7. 如果要選擇其他測試檔案時，可以直接在Perform Tests畫面下按Load去選擇；或可以按Setup Test選擇測試檔案後再按Perform Tests。
8. 如果要進行測試，請按TEST開關，此時面板上紅色的高電壓符號會閃爍，測試進行時請勿觸碰被測物件，以策安全。
9. 如果在測試進行中要中止測試，請按RESET開關，本分析儀立即停止測試，顯示器會保留當時的測試值。如要繼續進行測試，請再按面板上的TEST開關，程式會再繼續測試未完成的測試步驟，如果要重新由第一個測試步驟再開始測試時，請再按RESET開關，再按TEST開關，程式會自動由第一個測試步驟開始測試。
10. 如果由於被測物的測試失敗，本分析儀立即停止測試並且顯示器會顯示的狀態和失敗時的數值，此時紅色RESET開關內的指示燈會亮，同時發出嗶的警告聲音。如要繼續進行測試，請再按面板上的TEST開關，程式會再繼續測試未完成的測試步驟，如果要重新由第一個測試步驟再開始測試時，請先按RESET開關，再按TEST開關，程式會自動由第一個測試步驟開始測試。也可以按RESET開關關閉警報聲音而保留測試讀值，但再按TEST開關時，程式會自動由第一個測試步驟開始測試。有關各種測試失敗的顯示器信息，請參考顯示器信息的說明。
11. SE具有螢幕保護程式，當儀器超過30分鐘未被操作將進入螢幕保護畫面。碰觸儀器螢幕與RESET按鍵則會解除螢幕保護程式畫面。此功能不影響正在執行輸出測試的功能。
12. 如果要使用外部遙控裝置操作本耐壓測試器，請將遙控器接到背板上的遙控輸入端子上。遙控器上TEST和RESET開關的功能、作用與本分析儀上的開關完全相同。

13.本分析儀備有PASS、FAIL和PROCESSING遠端監視信號的輸出和遙控呼叫三組記憶組的功能，如要使用這些功能，請參考遙控輸入和輸出訊號的說明。

14.下圖為本儀器與待測物的接線圖範例，請參考下圖所示的接線並確認待測物或其測試治具上的各項接線是否接受。



備註：

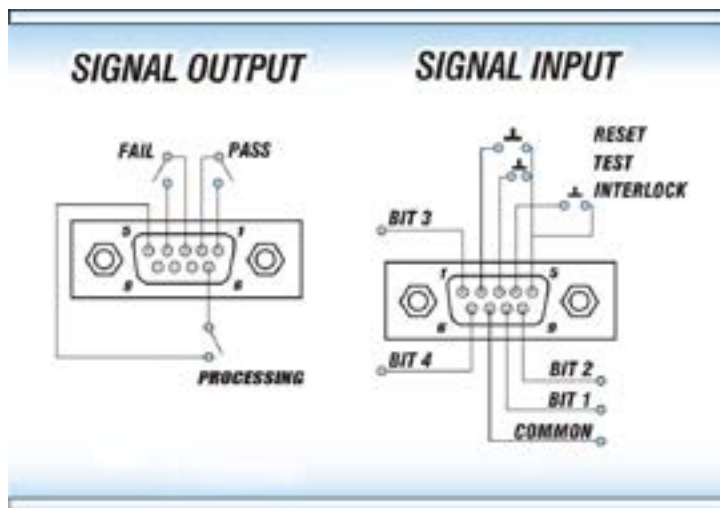
高壓線(H.V.)與迴路線(RETURN)請勿綁在一起，避免造成干擾等問題。若還是有干擾狀況發生，建議可以在RETURN端子處增加磁扣。

第六章 介面說明

6.1 標準遙控介面(Remote I/O)

在本分析儀的背板上配置有兩個D型(9PIN)連接端子，提供為遙控輸入控制訊號和輸出信息。這些連接端子和標準的D型(9PIN)連接頭互相匹配，必須由使用者自備。為了能達到最佳的效果，建議使用隔離線作為控制或信息的連接線，為了不使隔離地線成為一個迴路而影響隔離效果，必須將隔離線一端的隔離網接地。

背板遙控介面：



6.1.1 遙控訊號輸出(Signal Output)

在本分析儀的背板上備有遙控訊號輸出端子，將儀器的測試通過(PASS)、測試失敗(FAIL)和測試中(PROCESSING)等訊號，提供為遙控監視之用。這些訊號的現狀分別由儀器內部三個繼電器(Relay)提供不帶電源的常開(N.O.)接點，其接點的容量為：AC 120V 1.0 Amp/DC 24V 0.5 Amp。

備註：這些接點沒有正負極性的限制，同時每一個信號是獨立的接線，沒有共同的地線(COMMON)。訊號是由本儀器背板上配置的D型(9 PIN)連接端子輸出，端子上附有腳位編號的標示，每個輸出訊號的接線分別如下：

1. PASS訊號 接在PIN 1和PIN 2之間。
2. FAIL訊號 接在PIN 3和PIN 4之間。
3. PROCESSING訊號 接在PIN 5和PIN 6之間。
4. 空腳 PIN 9為未使用的空腳。

6.1.2 遙控訊號輸入與記憶程式

在本分析儀的背板上配置有遙控訊號輸入端子，可以由外接遙控裝置操作儀器的INTERLOCK和TEST及RESET的功能或呼叫預設於三組記憶程式中的任何一組測試參數，逕行使用另外的測試開關，直接進行測試，不需由面板設定和使用面板上的"TEST"開關。當PLC遙控功能設定為ON時，面板上的TEST開關被設定為不能操作，以避免雙重操作引起的誤動作和危險，此時面板上的RESET開關依然可以操作，以便隨時在任何地方都可以關閉高壓輸出。

備註：如不使用遙控裝置操作時，需將解除鎖定附件(INTERLOCK)，安裝至遙控訊號輸入端子上。

以下為遙控裝置的接線方式：

1. RESET控制 控制開關接在PIN 2和PIN 5之間
 2. TEST控制 控制開關接在PIN 3和PIN 5之間
 3. INTERLOCK控制 控制開關接在PIN 4和PIN 5之間
- PIN 5、PIN7為遙控電路的共同(COMMON)地線

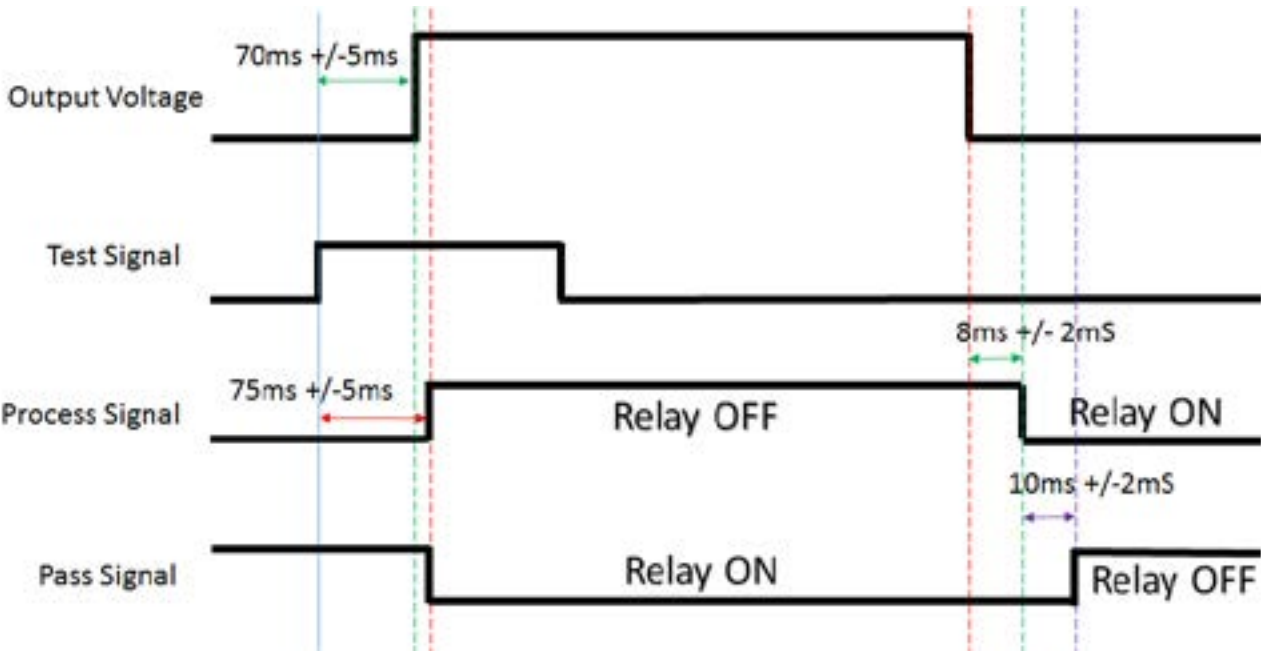
注意：

絕對不能再接上任何其它的電壓或電流電源，如果輸入其它的電源，會造成儀器內部控制電路的損壞或誤動作。

遙控記憶程式的訊號輸入，必須使用常開(N.O.)的瞬接(MOMENTARY)開關作為控制的工具，以下為其接線方式：

1. 第一組記憶程式 控制開關接在PIN 5和PIN 8之間
 2. 第二組記憶程式 控制開關接在PIN 5和PIN 9之間
 3. 第四組記憶程式 控制開關接在PIN 1和PIN 5之間
 4. 第八組記憶程式 控制開關接在PIN 5和PIN 6之間
- PIN 5、PIN7為遙控記憶程式的訊號輸入電路的共同(COMMON)地線

6.1.3 控制時序

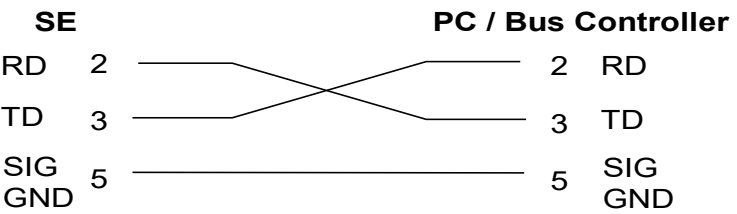


6.2 USB & RS232/GPIB介面

本章節提供USB & RS232和GPIB介面的正確使用方法及資訊，兩種介面的指令清單完全相同。RS232介面為SE的標準配備。本系列產品都具有配置RS232及GPIB介面的能力。

6.2.1 RS232介面

RS232連接方式必須符合9 PIN的串列式通信介面埠(SERIAL Port)，如下圖所示：



其通信埠須符合以下的結構：9600 baud、8 data bits、1 stop bit、no polarity等。這個介面不支援XON/XOFF的protocol和任何硬體方式的 Handshaking。控制器(Controller)的架構必須具有排除Handshaking Lines DTR(PIN 4)、DSR(PIN 6)及RTS(PIN 9)的功能。如果這通信埠不能經由軟體方式排除Handshaking Lines時，Handshaking Lines則應分兩個不同組群，分別跳接在一起。PIN 4和6、PIN 7和8必須在控制器電纜的末端接合在一起。

當指令經由RS232 Bus送給SE時，假如所傳送的字串(String)可以被本分析儀辨識或接受，本分析儀會回應一個證明字串給控制器。這是一種軟體方式的Handshaking，可以控制和監視資料(Data)的傳送。如所傳送的指令字串有錯誤，本分析儀會以15h或NAK的ASCII控制碼作為回應。若傳送資料被接受，會回應原傳送字串或電腦所需讀回之資料字串。當字串傳輸或Command傳輸結束時，需加結束碼LF=(0AH);如"TEST"+LF。

6.2.2 指令

6.2.2.1 指令結束碼

本章節所使用的指令，請依所用的程式語言於每個字串或Command結束時，皆需加字元結束碼(EOI)做結束確認。以TEST為例：

- a. 十六進制結束碼為 "0AH"，請輸入 "0X54,0X45,0X53,0X54,0X0A"
- b. ASCII 碼結束碼為 "LF"，請輸入 "TEST"
- c. C 語言結束碼為 "\n"，請輸入 "TEST\n"。

若撰寫程式時，指令與指令間需間隔150ms以上做為緩衝時間。(指令回讀時間最短為150ms)
檔案編輯的指令需要間隔 400ms。

6.2.2.2 快速設定指南

若想要增加一個ACW、IR、GB的測試項目，測試條件如下：

ACW：測試電壓為3000V、測試時間為5s、電流總和上限為10mA

IR：測試電壓為1000V、測試時間為3s、阻抗下限設定為2MΩ

GB：測試電流為30A、測試時間為5s、阻抗上限為100mΩ

指令輸入順序為：

1. "FN 1,TEST":建立一個名稱為"TEST"的檔案，且檔案順序為1；
2. "SAA":建立一個ACW的測試項，其內部數值為預設值；
3. "EV 3000":將ACW的測試電壓設定為3000V；
4. "EDW 5":將ACW的測試時間設定為5s；
5. "EHT 10":將ACW的電流總和上限設定為10mA；
6. "SAI":建立一個IR的測試項，其內部數值為預設值；
7. "EV 1000":將IR的測試電壓設定為1000V；
8. "EDW 3":將IR的測試時間設定為3s；
9. "EL 2":將IR的阻抗下限設定為2MΩ；
10. "SAG":建立一個GB的測試項，其內部數值為預設值；
11. "EC 30":將GB的測試電流設定為30A；
12. "EDW 5":將GB的測試時間設定為5s；
13. "EH 100":將GB的阻抗上限設定為100mΩ；
14. "FS":此時所有設定項皆暫存在RAM裡，輸入此指令可存檔在ROM中。

按照以上順序，即可完整設定一個ACW、IR、GB的連續測試流程。

6.2.2.3 指令清單

下列指令被作為驅動ON/OFF功能或選擇各種參數表之用。執行這些指令時，不需使用任何其他數值或參數。然而在使用於某項特定功能(Function Specific)的指令時，這些功能選擇指令，需建立新檔案(COMMAND:FN nn,xxxx)及記憶組位址(COMMAND:SS nn)必須要先執行，以便進入各項功能編輯參數。

1. 測試指令

指令	範圍	說明
TEST		執行測試
RESET		停止測試

若要執行測試，指令為"TEST"; 若要停止測試，指令為"RESET"。

2. 檔案編輯指令

指令	範圍	說明
FL nn	nn=01-200	讀取檔案
FN nn,xxxx	nn=01-200, xxx=name	建立新檔
LF?	work file now	查詢目前檔案及名稱
LF nn?		查詢檔案及名稱
FD	work file now	刪除目前檔案
FD nn	nn=01-200	刪除指定檔案
FS	work file now	儲存目前檔案
FSA nn,xxxx	nn=01-200 xxx=name	另存檔案
ST?		查詢檔案內有幾個測試步驟
FT?		查詢當下總共有幾個資料夾
SS nn	nn=01-200	選擇測試步驟
SS?	nn=01-200	查詢測試步驟
SD	work STEP now	刪除目前步驟
SD nn	nn=01-200	刪除指定步驟
SP	clr prompt	清除即時訊息
SP xxxxx	xxxx=string	編輯即時訊息
LP?	work STEP now	查詢目前欄位的即時訊息
LP nn?		查詢指定STEP的即時訊息
SPW xxxx	xxxx=Password	檔案加密設定
SPW?		詢問設定密碼

指令設定範例

若步驟名稱要設定為EXTECH，指令為"SN EXTECH"; 若要查詢此測試步驟的名稱，指令為"SN?"，即可讀取到設定的字串。

3. 系統參數指令

指令	範圍	說明
TD?	Testing data	查詢測試結果全部讀值
RD nn?	nn=1-200	讀取所指定的測試步驟的測試結果
RR?	0=CLOSE 1=OPEN	查詢RESET狀態
RI?	0=CLOSE 1=OPEN	查詢INTERLOCK狀態
RS?	0=None, 1=External 1 2=External 2 3=Both External	查詢Scanner port 連接狀態
SSG2 n	n=0, 0.4-5.0	設定Smart GFI狀態
SSG2?		查詢Smart GFI設定狀態
SPR n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定遠端控制(PLC Remote)狀態
SPR?		查詢遠端控制(PLC Remote)設定狀態
SSI n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定單一步驟測試(Single Step)狀態
SSI?		查詢單一步驟測試(Single Step)狀態
SF n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定測試失敗停止(Fail Stop)功能
SF?		查詢測試失敗停止(Fail Stop)功能狀態
SAL n	n=0-9	設定警報音量
SAL?		查詢警報音量
SL n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定使用者權限功能
SL?		查詢使用者權限設定狀態
SCA n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定校正日期預警
SCA?		查詢校正日期預警設定狀態
CA n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定校正日期預警
CA?		查詢校正日期預警設定狀態
SCDA mm,dd,yy	Date Format by SDF	設定校正日期
SCDA?	Date Format by SDF	查詢校正日期設定狀態
SCDU mm,dd,yy	Date Format by SDF	設定下次校正時間
SCDU?	Date Format by SDF	查詢下次校正時間設定狀態
SA mm,dd,yy	Date Format by SDF	設定警報日期
SA?	Date Format by SDF	查詢警報日期設定狀態
CAD mm,dd,yy	Date Format by SDF	設定警報日期
CAD?	Date Format by SDF	查詢警報日期設定狀態
SDT mm,dd,yy	Date Format by SDF	設定日期
SDT?	Date Format by SDF	查詢日期設定狀態

SDF n	n=0-2 0=ymd 1=mdy 2=dmy	設定日期格式
SDF?		查詢日期格式設定狀態
STM hh,mm	Time Format by STF	設定時間
STM?	Time Format by STF	查詢時間設定狀態
STF n	n=0-1, 0=12hr, 1=24hr	設定時間格式
STF?		查詢時間格式設定狀態
SMM n	n=0-2, 0= Menu 1= Perform Tests 2= My Menu	設定開機後顯示主畫面
SMM?		查詢開機後顯示主畫面設定狀態
SAN n	n=0-2, 0=Continue 1=PAUSE 2=Skip	設定開機動畫顯示
SAN?		查詢開機動畫顯示設定狀態
SLA n	n=0 – 2 0=English 1= Traditional Chinese 2=Simplified Chinese	設定語言
SLA?		查詢語言設定狀態
SCT n	n=0-1, 0=Dull 1=Vivid,	設定顏色
SCT?		查詢顏色設定狀態
SUL n?	n=0-8 Name,Password,Level	查詢使用者權限人員設定狀態
SUA p,p,p,p	SUA Pointer,Name,Pass- word,Level Pointer:1-8 Name:8 character max Password:8 character max Level: 0=Run Only, 1=Edit Step, 2=Recall Setup, 3=Full System	設定使用者名單
SUE p,p,p,p	SUE Pointer,Name,Pass- word,Level Pointer:1-8 Name:8 character max Password:8 character max Level: 0=Run Only, 1=Edit Step, 2=Recall Setup, 3=Full System	編輯使用者名單
SUD n	n=1 – 8	刪除使用者
SM n	n=0-1, 0=True RMS, 1=Average	設定量測值

SM?		
SPV n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定步驟連結不斷電
SPV?		查詢步驟連結不斷電設定狀態
SSS n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定螢幕保護
SSS?		查詢螢幕保護設定狀態
SJAB n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定A/B測試
SJAB?		查詢A/B測試設定狀態
SBR n	n=0-2, 0=9600,1=19200,2=38400	設定鮑率
SBR?		查詢鮑率設定狀態
SIS		導入系統參數
SIF nnnnnnnn	nnn=name	導入檔案
SIAF nnnnnnnn	Import All File	導入所有檔案
SIAD nnnnnnnn	Import All Data	導入所有資料
SRF?	Read USB.HU4 File	讀取 USB.HU4檔案
SRAF?	Read USB.AF File	讀取 USB.AF檔案
SRAD?	Read USB.AFS File	讀取 USB.AFS檔案
SES	Export System	導出系統參數
SEF n	Export File	導出檔案
SEAF nnnnnnnn	Export All File	導出所有檔案
SEAD nnnnnnnn	Export All Data	導出所有資料
SBI n	n=1 – 4 0=OFF, 1=SER/PROD, 2=SERI- AL#, 3=PRODUCT#, 4=RUN FILE	設定條碼掃描
SBI?		查詢條碼掃描設定狀態
SAS n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定自動存檔
SAS?		查詢自動存檔設定狀態
STR n	n=0-3, 0=ALL 1=FAIL 2=PASS 3=NONE	設定資料儲存
STR?		查詢資料儲存設定狀態
SBI n	n=0-4, 0=OFF, 1=SER/PROD, 2=SERIAL#, 3=PRODUCT#, 4=RUN FILE	設定條碼掃描
SBI?		查詢條碼掃描設定狀態
SAS n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定條碼掃描後自動測試
SAS?		查詢條碼掃描後自動測試的設定狀態
SRE n	n=0-1, 0=Step, 1=Last	Reflash設定
SRE?		Reflash狀態查詢
SRC n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	ReSet Clear設定
SRC?		ReSet Clear狀態查詢
SAF n	n=0-1, 0=10k~30k Hz, 1=10k~150k Hz	設定ARC檢測頻率
SAF?		查詢ARC檢測頻率設定狀態

指令設定範例

若遠端控制(PLC Remote)要設定為ON,指令為"SPR 1";若要查詢遠端控制(PLC Remote)的設定狀態,指令為"SPR?",即可讀取到設定的字串。

備註: TD?中的指令可以詢問到的狀態有Ramp Up | Delay | Dwell | Ramp Down | PASS | ABORT | Charge-LO | Breakdown | Short | Ramp-HI | GND-Fault | HI-LIMIT | LO-LIMIT | HI-LIMIT R | LO-LIMIT T | LO-LIMIT R | HI-LIMIT V | LO-LIMIT V | CONT-Fail | ARC-Fail | OUTPUT-ERROR | OTP-Fail | Discharge

4. 測試參數指令

ACW相關指令

指令	範圍	說明
SAA		新增ACW測試項目,此指令會在FILE裡新增一個ACW的測試項目。
測試電壓		
EV nnnn	nnnn=0-5000	設定ACW"測試電壓(Voltage)"
EV?	V	查詢ACW"測試電壓(Voltage)"的設定值
電流限制		
EHT nnnn	By Model & Function	設定ACW"電流總和上限(HI-Limit Total)"
EHT?	mA	查詢ACW"電流總和上限(HI-Limit Total)"的設定值
ELT nnnn	By Model & Function	設定ACW"電流總和下限(LO-Limit Total)"
ELT?	mA	查詢ACW"電流總和下限(LO-Limit Total)"的設定值
EHR nnnn	By Model & Function	設定ACW"真實電流上限(HI-Limit Real)"
EHR?	mA	查詢ACW"真實電流上限(HI-Limit Real)"的設定值
ELR nnnn	By Model & Function	設定ACW "真實電流下限(LO-Limit Real)"
ELR?	mA	查詢ACW "真實電流下限(LO-Limit Real)"的設定值
歸零設置		
EO nnnn	By Model & Function	設定ACW"歸零設置(Offset)"
EO?	mA	查詢ACW"歸零設置(Offset)"的設定值
SAO		執行自動歸零校正功能。

時間		
ERU nnn.n	nnn.n=0.1-999.9	設定ACW"緩升時間(Ramp UP)"
ERU?	s	查詢ACW"緩升時間(Ramp UP)"的設定值
ERD nnn.n	nnn.n=0.0-999.9	設定ACW"緩降時間(Ramp Down)"
ERD?	s	查詢ACW"緩降時間(Ramp Down)"的設定值
EDW nnn.n	nnn.n=0, 0.4-999.9	設定ACW"測試時間(Dwell Time)"
EDW?	s	查詢ACW"測試時間(Dwell Time)"的設定值
電弧靈敏度		
EA nn	nn=1-9	設定ACW "電弧靈敏度(ARC Sense)"
EA?		查詢ACW "電弧靈敏度(ARC Sense)"的設定值
輸出頻率		
EF n	n=0-1, 0=50, 1=60	設定ACW "輸出頻率(Frequency)"
EF?	Hz	查詢ACW "輸出頻率(Frequency)"的設定值
導通測試		
ECT n	ECT n	ECT n
ECT?	ECT?	ECT?
電弧判定模式		
EAD n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定ACW "電弧判定模式(Arc Detect)"
EAD?		查詢ACW "電弧判定模式(Arc Detect)"的設定值
電流檔位		
ERG n	n=0-1, 0=Auto 1=Fixed	設定ACW "電流檔位(Range)"
ERG?		查詢ACW "電流檔位(Range)"的設定值
矩陣式掃瞄器		
ES xxxxxxxx	x=H or L or O	設定ACW "矩陣式掃瞄器(Scanner)"
ES?		查詢ACW "矩陣式掃瞄器(Scanner)"的設定值

指令設定範例

- 若ACW的"測試電壓(Voltage)"要設定2500V,指令為"EV 2500"。
- 若要查詢ACW目前"測試電壓(Voltage)"的設定值,指令為"EV?",即可讀取到設定的字串。
- 若ACW的"電流總和上限(HI-Limit Total)"要設定25.01mA,指令為"EHT 25.01"。
- 若要查詢ACW目前"電流總和上限(HI-Limit Total)"的設定值,指令為"EHT?",即可讀取到設定的字串。
- 若ACW的"歸零設置(Offset)"要設定0mA,指令為"EO 0"。

備註: Offset只能執行自動歸零設定,若要執行手動設定的話,只能將值設為0。

- 若要查詢ACW目前"歸零設置(Offset)"的設定值,指令為"EO?",即可讀取到設定的字串。
- 若要讓SE自動讀取"歸零設置(Offset)"的數值,指令為"SAO",SE會自動執行讀取功能。

- 若ACW的"緩升時間(Ramp UP)"要設定10s,指令為"ERU 10"。
- 若要查詢ACW目前"緩升時間(Ramp UP)"的設定值,指令為"ERU?",即可讀取到設定的字串。
- 若ACW的"電弧靈敏度(ARC Sense)"要設定6,指令為"EA 6"。
- 若要查詢ACW目前"電弧靈敏度(ARC Sense)"的設定值,指令為"EA?",即可讀取到設定的字串。
- 若ACW的"輸出頻率(Frequency)"要設定50Hz,指令為"EF 0"。
- 若要查詢ACW目前"輸出頻率(Frequency)"的設定值,指令為"EF?",即可讀取到設定的字串。
- 若ACW的"電弧判定模式(Arc Detect)"要設定關閉,指令為"EAD 0"。
- 若要查詢ACW目前"電弧判定模式(Arc Detect)"的設定值,指令為"EAD?",即可讀取到設定的字串。
- 若ACW的"電流檔位(Range)"要設定自動換檔,指令為"ERG 0"。
- 若要查詢ACW目前"電流檔位(Range)"的設定值,指令為"ERG?",即可讀取到設定的字串。
- 若ACW的"矩陣式掃描器(Scanner)"要設定第1、3通道為高壓端,第2、4通道為迴路端,其他通道不使用,其指令為"ES HLHLOOOO"。
- 若要查詢ACW目前"矩陣式掃描器(Scanner)"的設定值,指令為"ES?",即可讀取到設定的字串。

DCW相關指令

指令	範圍	說明
SAD		新增DCW測試項目,此指令會在FILE裡新增一個DCW的測試項目。
測試電壓		
EV nnnn	nnnn=0-6000	設定DCW"測試電壓(Voltage)"
EV?	V	查詢DCW"測試電壓(Voltage)"的設定值
輸出極性		
EPO n	n=0-1, 0=+, 1=-	設定DCW"輸出極性設定(Output Polarity)"
EPO?		查詢DCW"輸出極性設定(Output Polarity)"的設定值
電流限制		
EH nnnn	nnnn=0.0-10000	設定DCW"電流上限(HI-Limit)"
EH?	uA	查詢DCW"電流上限(HI-Limit)"的設定值
EL nnnn	nnnn=0.0-10000	設定DCW"電流下限(LO-Limit)"
EL?	uA	查詢DCW"電流下限(LO-Limit)"的設定值
歸零設置		
EO nnnn	nnnn=0.0-10000	設定DCW"歸零設置(Offset)"
EO?	uA	查詢DCW"歸零設置(Offset)"的設定值
SAO		執行自動歸零校正功能。

時間		
ERU nnn.n	snnn.n=0.4-999.9	設定DCW"緩升時間(Ramp UP)"
ERU?	s	查詢DCW"緩升時間(Ramp UP)"的設定值
ERD nnn.n	nnn.n=0, 1.0-999.9	設定DCW"緩降時間(Ramp Down)"
ERD?	s	查詢DCW"緩降時間(Ramp Down)"的設定值
EDW nnn.n	nnn.n=0, 0.3-999.9	設定DCW"測試時間(Dwell Time)"
EDW?	s	查詢DCW"測試時間(Dwell Time)"的設定值
電弧靈敏度		
EA nn	nn=1-9	設定DCW "電弧靈敏度(ARC Sense)"
EA?		查詢DCW "電弧靈敏度(ARC Sense)"的設定值
緩衝電流		
ERH n	n= 0-10000	設定DCW "緩衝電流(RAMP-HI)"
ERH?	uA	查詢DCW "緩衝電流(RAMP-HI)"的設定值
導通測試		
ECT n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定DCW"導通測試(Continuity)"
ECT?		查詢DCW"導通測試(Continuity)"的設定值
充電下限		
EAD n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定ACW "電弧判定模式(Arc Detect)"
EAD?		查詢ACW "電弧判定模式(Arc Detect)"的設定值
電弧判定模式		
EAD n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定DCW "電弧判定模式(Arc Detect)"
EAD?		查詢DCW "電弧判定模式(Arc Detect)"的設定值
電流檔位		
ERG n	n=0-1, 0=Auto 1=Fixed	設定DCW "電流檔位(Range)"
ERG?		查詢DCW "電流檔位(Range)"的設定值
電流低解析設定		
ELG n	n=0-1, 0=OFF, 1=ON	設定DCW 電流低解析設定(Low Range)
ELG?		查詢DCW "電流低解析設定(Low Range)"的設定值
矩陣式掃描器		
ES xxxxxxxx	x=H or L or O	設定DCW "矩陣式掃描器(Scanner)"
ES?		查詢DCW "(矩陣式掃描器(Scanner))"的設定值

指令設定範例

- 若DCW的"測試電壓(Voltage)"要設定1500V,指令為"EV 1500"。
- 若要查詢DCW目前"測試電壓(Voltage)"的設定值,指令為"EV?",即可讀取到設定的字串。
- 若DCW的"電流上限(HI-Limit)"要設定1000uA,指令為"EH 1000"。
- 若要查詢DCW目前"電流上限(HI-Limit)"的設定值,指令為"EH?",即可讀取到設定的字串。
- 若DCW的"歸零設置(Offset)"要設定5uA,指令為"EO 5"。
- 若要查詢DCW目前"歸零設置(Offset)"的設定值,指令為"EO?",即可讀取到設定的字串。
- 若要讓SE自動讀取"歸零設置(Offset)"的數值,指令為"SAO",SE即會自動執行讀取功能。
- 若DCW的"緩升時間(Ramp UP)"要設定10 s,指令為"ERU 10"。
- 若要查詢DCW目前"緩升時間(Ramp UP)"的設定值,指令為"ERU?",即可讀取到設定的字串。
- 若DCW的"電弧靈敏度(ARC Sense)"要設定6,指令為"EA 6"。
- 若要查詢DCW目前"電弧靈敏度(ARC Sense)"的設定值,指令為"EA?",即可讀取到設定的字串。
- 若DCW的"緩衝電流(RAMP-HI)"要設定20uA,指令為"ERH 20"。
- 若要查詢DCW目前"緩衝電流(RAMP-HI)"的設定值,指令為"ERH?",即可讀取到設定的字串。
- 若DCW的"充電下限(Charge Lo)"要設定50uA,指令為"ECG 50"。
- 若要查詢DCW目前"充電下限(Charge Lo)"的設定值,指令為"ECG?",即可讀取到設定的字串。
- 若要讓SE自動讀取"充電下限(Charge Lo)"的數值,指令為"SACG",SE即會自動執行讀取功能。
- 若DCW的"電弧判定模式(Arc Detect)"要設定關閉,指令為"EAD 0"。
- 若要查詢DCW目前"電弧判定模式(Arc Detect)"的設定值,指令為"EAD?",即可讀取到設定的字串。
- 若DCW的"電流檔位(Range)"要設定自動換檔,指令為"ERG 0"。
- 若要查詢DCW目前"電流檔位(Range)"的設定值,指令為"ERG?",即可讀取到設定的字串。
- 若DCW的"電流低解析設定(Low Range)"要設定關閉,指令為"ELG 0"。
- 若要查詢DCW目前"電流低解析設定(Low Range)"的設定值,指令為"ELG?",即可讀取到設定的字串。
- 若DCW的"矩陣式掃描器(Scanner)"要設定第1、3通道為高壓端,第2、4通道為迴路端,其他通道不使用,其指令為"ES HLHLOOOO"。
- 若要查詢DCW目前"矩陣式掃描器(Scanner)"的設定值,指令為"ES?",即可讀取到設定的字串。

IR相關指令

指令	範圍	說明
SAI		新增IR測試項目,此指令會在FILE裡新增一個IR的測試項目。
測試電壓		
EV nnnn	nnnn=0-6000	設定IR"測試電壓(Voltage)"
EV?	V	查詢IR"測試電壓(Voltage)"的設定值
輸出極性		
EPO n	n=0-1, 0=+, 1=-	設定DCW"輸出極性設定(Output Polarity)"
EPO?		查詢DCW"輸出極性設定(Output Polarity)"的設定值
阻抗限制		
EH nnnn	nnnn=0-50000	設定IR"阻抗上限(HI-Limit)"
EH?	MΩ	查詢IR"阻抗上限(HI-Limit)"的設定值
EL nnnn	nnnn=0-50000	設定IR"阻抗下限(LO-Limit)"
EL?	MΩ	查詢IR"阻抗下限(LO-Limit)"的設定值
時間		
ERU nnn.n	nnn.n=0.1-999.9	設定IR"緩升時間(Ramp UP)"
ERU?	s	查詢IR"緩升時間(Ramp UP)"的設定值
ERD nnn.n	nnn.n=0, 1.0-999.9	設定IR"緩降時間(Ramp Down)"
ERD?	s	查詢IR"緩降時間(Ramp Down)"的設定值
EDW nnn.n	nnn.n=0, 0.5-999.9	設定IR"測試時間(Dwell Time)"
EDW?	s	查詢IR"測試時間(Dwell Time)"的設定值
EDE nnn.n	nnn.n=0.5-999.9	設定IR"延遲時間(Delay Time)"
EDE?	s	查詢IR"延遲時間(Delay Time)"的設定值
充電下限		
ECG nnnn	nnnn=0.000-350 0.000-3.5000	設定IR"充電下限(Charge Lo)"
ECG?	uA	查詢IR"充電下限(Charge Lo)"的設定值
SACG		執行自動設定充電下限功能
充電下限		
ERG n	n=0-1, 0=Auto 1=Fixed	設定IR "電流檔位(Range)"
ERG?		查詢IR "電流檔位(Range)"的設定值
矩陣式掃描器		
ES xxxxxxxx	x=H or L or O	設定IR "矩陣式掃描器(Scanner)"
ES?		查詢IR "矩陣式掃描器(Scanner)"的設定值

指令設定範例

- 若IR的"測試電壓(Voltage)"要設定500V,指令為"EV 500"。
- 若要查詢IR目前"測試電壓(Voltage)"的設定值,指令為"EV?",即可讀取到設定的字串。
- 若IR的"阻抗上限(HI-Limit)"要設定2000MΩ,指令為"EH 2000"。
- 若要查詢IR目前"阻抗上限(HI-Limit)"的設定值,指令為"EH?",即可讀取到設定的字串。
- 若IR的"緩升時間(Ramp UP)"要設定10 s,指令為"ERU 10"。
- 若要查詢IR目前"緩升時間(Ramp UP)"的設定值,指令為"ERU?",即可讀取到設定的字串。
- 若IR的"充電下限(Charge Lo)"要設定50uA,指令為"ECG 50"。
- 若要查詢IR目前"充電下限(Charge Lo)"的設定值,指令為"ECG?",即可讀取到設定的字串。
- 若要讓SE自動讀取"充電下限(Charge Lo)"的數值,指令為"SACG",SE即會自動執行讀取功能。
- 若IR的"電流檔位(Range)"要設定自動換檔,指令為"ERG 0"。
- 若要查詢IR目前"電流檔位(Range)"的設定值,指令為"ERG?",即可讀取到設定的字串。
- 若IR的"矩陣式掃瞄器(Scanner)"要設定第1~3通道為高壓端,第2~4通道為迴路端,其他通道不使用,其指令為"ES HLHLOOOO"。
- 若要查詢IR目前"矩陣式掃瞄器(Scanner)"的設定值,指令為"ES?",即可讀取到設定的字串。

GND相關指令

指令	範圍	說明
SAG		新增Ground Bond測試項目,此指令會在FILE裡新增一個GND的測試項目。
輸出電流		
EC nnnn	by Model & Function	設定GND"輸出電流(Current)"
EC?	A	查詢GND"輸出電流(Current)"的設定值
輸出電壓		
EV nnnn	nnnn=3.00-8.00	設定GND"輸出電壓(Voltage)"
EV?	V	查詢GND"輸出電壓(Voltage)"的設定值
電壓限制		
EHV nnnn	nnnn=0.00-6.00V, 0=OFF	設定GND"電壓上限(HI-Lmt V)"
EHV?		查詢GND"電壓上限(HI-Lmt V)"的設定值
ELV nnnn	nnnn=0.00-6.00V, 0=OFF	設定GND"電壓下限(LO-Lmt V)"
ELV?		查詢GND"電壓下限(LO-Lmt V)"的設定值
GBM?		查詢GND的量測阻抗
GBV?		查詢GND的量測電壓
阻抗限制		
EH nnnn	nnnn=0-600	設定GND"阻抗上限(HI-Limit)"
EH?	mΩ	查詢GND"阻抗上限(HI-Limit)"的設定值
EL nnnn	nnnn=0-600	設定GND"阻抗下限(LO-Limit)"
EL?	mΩ	查詢GND"阻抗下限(LO-Limit)"的設定值

測試時間		
EDW nnn.n	nnn.n=0, 0.5-999.9	設定GND"測試時間(Dwell Time)"
EDW?	s	查詢GND"測試時間(Dwell Time)"的設定值
歸零設置		
EO nnnn	nnn.n=0-200	設定GND"歸零設置(Offset)"
EO?	mΩ	查詢GND"歸零設置(Offset)"的設定值
SAO		執行自動歸零校正功能。
歸零設置		
EOV nnn	Nnn=0.00-6.00	設定GND"電壓歸零設置(Offset)"
EOV?		查詢GND"電壓歸零設置(Offset)"的設定值
輸出頻率		
EF n	n=0-1, 0=50, 1=60	設定GND "輸出頻率(Frequency)"
EF?	Hz	查詢GND "輸出頻率(Frequency)"的設定值
矩陣式掃瞄器		
ESN nn	n=1-16	設定GND "矩陣式掃瞄器(Scanner)"
ESN?		查詢GND "矩陣式掃瞄器(Scanner)"的設定值

指令設定範例

- 若GND的"輸出電流(Current)"要設定25A,指令為"EC 25"。
- 若要查詢GND目前"輸出電流(Current)"的設定值,指令為"EC?",即可讀取到設定的字串。
- 若GND的"阻抗上限(HI-Limit)"要設定100mΩ,指令為"EH 100"。
- 若要查詢GND目前"阻抗上限(HI-Limit)"的設定值,指令為"EH?",即可讀取到設定的字串。
- 若GND的"測試時間(Dwell Time)"要設定10 s,指令為"EDW 10"。
- 若要查詢GND目前"測試時間(Dwell Time)"的設定值,指令為"EDW?",即可讀取到設定的字串。
- 若GND的"歸零設置(Offset)"要設定3mΩ,指令為"EO 3"。
- 若要查詢GND目前"歸零設置(Offset)"的設定值,指令為"EO?",即可讀取到設定的字串。
- 若要讓SE自動讀取"歸零設置(Offset)"的數值,指令為"SAO",SE即會自動執行讀取功能。
- 若GND的"輸出頻率(Frequency)"要設定50Hz,指令為"EF 0"。
- 若要查詢GND目前"輸出頻率(Frequency)"的設定值,指令為"EF?",即可讀取到設定的字串。
- 若GND的"矩陣式掃瞄器(Scanner)"要設定第3通道輸出,指令為"ESN 3"。
- 若要查詢GND目前"矩陣式掃瞄器(Scanner)"的設定值,指令為"ESN?",即可讀取到設定的字串。

DC CONTINUITY相關指令 (選購OPT.7002)

指令	範圍	說明
SAC		新增DC CONTINUITY測試項目，此指令會在FILE裡新增一個DC CONTINUITY的測試項目。
阻抗限制		
EH nnnn	nnnn=0-10000	設定CONT"阻抗上限(HI-Limit)"
EH?	Ω	查詢CONT"阻抗上限(HI-Limit)"的設定值
EL nnnn	nnnn=0-10000	設定CONT"阻抗下限(LO-Limit)"
EL?	Ω	查詢CONT"阻抗下限(LO-Limit)"的設定值
EDW nnn.n	nnn.n=0, 0.3-999.9	設定CONT"測試時間(Dwell Time)"
EDW?	s	查詢CONT"測試時間(Dwell Time)"的設定值
歸零設置		
EO nnnn	nnnn=0.00-10.00	設定CONT"歸零設置(Offset)"
EO?	Ω	查詢CONT"歸零設置(Offset)"的設定值
SAO		執行自動歸零校正功能。
矩陣式掃描器		
ESN nn	n=1-16	設定CONT "矩陣式掃描器(Scanner)"
ESN?		查詢CONT "矩陣式掃描器(Scanner)"的設定值

指令設定範例

- 若CONT的"阻抗上限(HI-Limit)"要設定1000 Ω ，指令為"EH 1000"。
- 若要查詢CONT目前"阻抗上限(HI-Limit)"的設定值，指令為"EH?"，即可讀取到設定的字串。
- 若CONT的"測試時間(Dwell Time)"要設定10 s，指令為"EDW 10"。
- 若要查詢CONT目前"測試時間(Dwell Time)"的設定值，指令為"EDW?"，即可讀取到設定的字串。
- 若CONT的"歸零設置(Offset)"要設定3 Ω ，指令為"EO 3"。
- 若要查詢CONT目前"歸零設置(Offset)"的設定值，指令為"EO?"，即可讀取到設定的字串。
- 若要讓SE自動讀取"歸零設置(Offset)"的數值，指令為"SAO"，SE即會自動執行讀取功能。
- 若CONT的"矩陣式掃描器(Scanner)"要設定第3通道輸出，指令為"ESN 3"。
- 若要查詢CONT目前"矩陣式掃描器(Scanner)"的設定值，指令為"ESN?"，即可讀取到設定的字串。

共用指令

指令	範圍	說明
S5	1-50	設定記憶組(Memory)
S6	1-8	設定測試步驟(Step)
FQ		開啟步驟連結(Connect ON)
FR		關閉步驟連結(Connect OFF)
FS		開啟測試失敗停止模式(Fail Stop ON)
FT		關閉測試失敗停止模式(Fail Stop OFF)
EA		開啟防高壓觸電功能(Smart GFI ON)
EB		關閉防高壓觸電功能(Smart GFI OFF)
F0		Enable "All Pass"SRQ
F1		Disable "All Pass"SRQ
F2		Enable "Fail"SRQ
F3		Disable "Fail"SRQ
F4		Enable "Abort"SRQ
F5		Disable "Abort"SRQ
F6		Enable "Error Command"SRQ
F7		Disable "Error Command"SRQ

指令設定範例

若"記憶組(Memory)"要設定第25組，指令為"S5 25"；若"步驟連結(Connect)"要設定為ON，指令為"FQ"。

完整的測試參數設定

除了透過以上單一指令的方式設定外，可以利用 ADD3 的指令來設定完整的測試項。

指令	範圍	說明
ADD3 n,p,p,p,p.....		設定完整的測試項
LS3 nn?		查詢指定STEP的所有參數設定
LS3?		查詢目前STEP的所有參數設定

依底下各參數的定義，按照順序分別輸入欲設定的數值即可一次完成該測試項的參數。

ADD3 ACW,Voltage,HI-Limit T,LO-Limit T,Ramp Up,Dwell Time,Ramp Down,Arc Sense,HI-Limit R,LO-Limit R,Offset,Frequency,Arc Dectect,Continuity,Range,Scanner Setup

ADD3 DCW,Voltage,Output Polarity,HI-Limit,LO-Limit,Ramp Up,Dwell Time,Ramp Down,Charge LO,Arc Sense,Offset,Ramp-HI,Arc Dectect,Continuity,Range,Low Range,Scanner Setup

ADD3 IR,Voltage,Output Polarity,HI-Limit,LO-Limit,Ramp UP,Delay Time,Dwell Time,Ramp Down,Charge LO,Scanner Setup

ADD3 GND,Current,Voltage,HI-Limit,LO-Limit,HI-Limit V,LO-Limit V,Dwell Time,Offset,Offset V,Frequency,Scanner Channel

ADD3 CONT.,HI-Limit,LO-Limit,Dwell Time,Offset,Scanner Channel

完整的測試參數設定

指令	範圍	說明
ADD3 n,p,p,p,p,....		設定完整的測試項
LS3 nn?		查詢指定STEP的所有參數設定
LS3?		查詢目前STEP的所有參數設定

依底下各參數的定義，按照順序分別輸入欲設定的數值即可一次完成該測試項的參數。

ADD3 ACW,Voltage,HI-Limit T,LO-Limit T,Ramp Up,Dwell Time,Ramp Down,Arc Sense,HI-Limit R,LO-Limit R,Offset,Frequency,Arc Detect,Continuity,Range,Scanner Setup

ADD3 DCW,Voltage,Output Polarity,HI-Limit,LO-Limit,Ramp Up,Dwell Time,Ramp Down,Charge LO,Arc Sense,Offset,Ramp-HI,Arc Detect,Continuity,Range,Low Range,Scanner Setup

ADD3 IR,Voltage,Output Polarity,HI-Limit,LO-Limit,Ramp UP,Delay Time,Dwell Time,Ramp Down,Charge LO,Scanner Setup

ADD3 GND,Current,Voltage,HI-Limit,LO-Limit,HI-Limit V,LO-Limit V,Dwell Time,Offset,Offset V,Frequency,Scanner Channel

ADD3 CONT.,HI-Limit,LO-Limit,Dwell Time,Offset,Scanner Channel

5. 網路卡(Ethernet)設定指令

指令	範圍	說明
SIM n	n=0-1, 0=Auto, 1=Manual	設定IP 取得方式
SIM?		查詢IP 取得方式的狀態
SIA xxx.xxx.xxx.xxx	xxx=0~255	設定IP 位址
SIA?		查詢IP的位址
SGA xxx.xxx.xxx.xxx		設定IP閘道器
SGA?		查詢IP閘道器的位址
SSM xxx.xxx.xxx.xxx		設定子網路遮罩
SSM?		查詢子網路遮罩的位址
SDN nnnnnnnnnn	nnnnnnnnnn=Any word	設定設備名稱
SDN?		查詢設備名稱設定狀態
MAC?		查詢網路卡的 ID

6. GPIB讀取指令 (選購OPT.109)

當控制器傳送一個正確的S或F指令時，如在指令字串後面跟著送出一個GPIB讀取指令，分析儀會回應一個證明的指令字串。如在所送出的指令發生錯誤，本分析儀會在收到讀取指令之後，送出一個15H的ASCII控制碼。

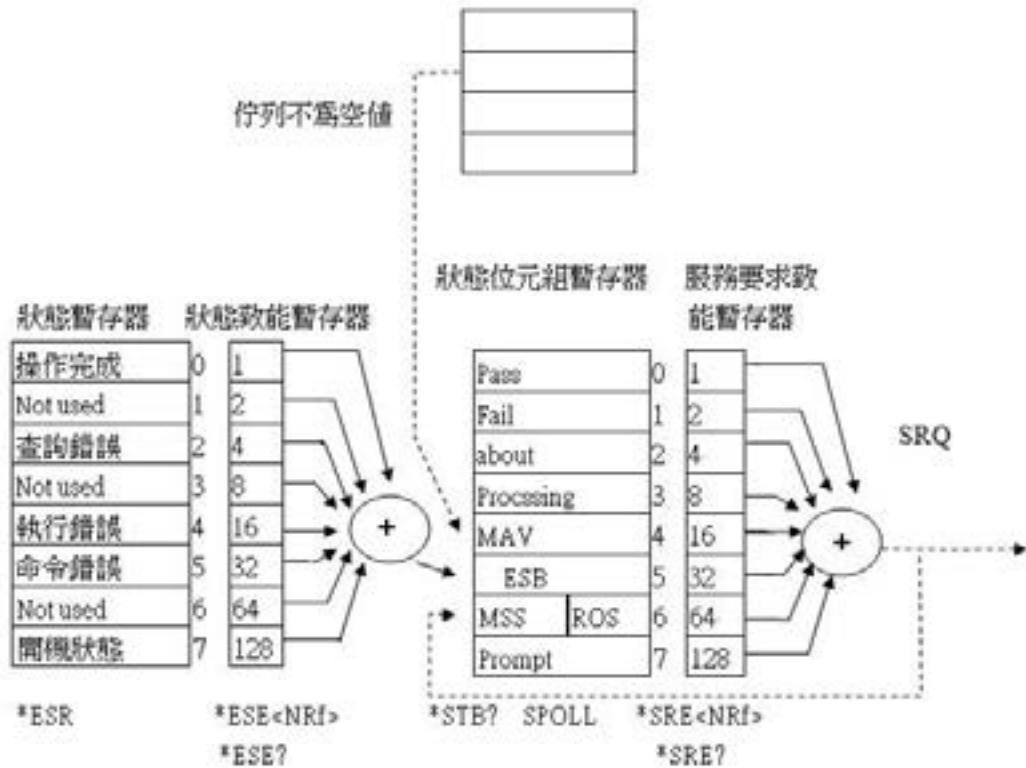
下列功能表為本分析儀在執行時用以讀取資料的指令，在寫每一個指令時，每一讀取指令必須具有適當的長度(如表內所示)的byte的空間，以便能夠讀取本分析儀的全部資料。

指令	所讀取資料的功能	所需BYTE的長度	說明
?1	測試步驟的Buffer 1	40	讀取第一測試步驟在顯示器上的測試結果
?2	測試步驟的 Buffer 2	40	讀取第二測試步驟在顯示器上的測試結果
?3	測試步驟的 Buffer 3	40	讀取第三測試步驟在顯示器上的測試結果
?4	測試步驟的Buffer 4	40	讀取第四測試步驟在顯示器上的測試結果
?5	測試步驟的 Buffer 5	40	讀取第五測試步驟在顯示器上的測試結果
?6	測試步驟的 Buffer 6	40	讀取第六測試步驟在顯示器上的測試結果
?7	測試步驟的 Buffer 7	40	讀取第七測試步驟在顯示器上的測試結果
?8	測試步驟的 Buffer 8	40	讀取第八測試步驟在顯示器上的測試結果
?A	接地電阻的Offset	5	讀取接地電阻的Offset設定，必須在接地電阻測試進行時才能讀取。
?B	DCW Charge-Lo	5	讀取DCW Charge-Lo設定，必須 DCW 測試進行時才能讀取。
?C	IR Charge-LO	5	讀取IR Charge-Lo設定，必須 IR測試進行時才能讀取。
?D	Remote ReSet Status	1	01 hex = ReSet ON 00 hex = ReSet OFF
?K	OLED Display	40	在測試後，讀取在顯示器上的測試結果

註明：如所送出的指令發生錯誤，本分析儀會在收到讀取指令之後，送出一個15h的ASCII控制碼。

6.2.2.4 標準狀態資料結構

標準狀態資料結構，整個結構圖表示法以下圖所示加以說明。圖中使用暫存器模式狀態資料結構表示法，定義出標準事件狀態暫存器(Standard Event Status Enable Register)和標準事件狀態致能暫存器(Standard Event Status Enable Register)，用以產生ESB彙總訊息(狀態位元組暫存器位元 5)；另外，使用佇列型狀態資料結構表示法，定義輸出佇列，用以產生輸出佇列，用以產生MAV彙總訊息(狀態位元組暫存器位元 4)。接著，分別針對標準所定義之暫存器與佇列予以詳細說明。



6.2.2.5 標準事件狀態暫存器

IEEE 488.2標準定義了標準事件狀態暫存器，明確描述了裝置所必須實現的事件狀態，每個位元所代表的事件內容說明如下：

1. 位元0：操作完成(OPC, Operation Complete)位元
位元0是用來指示裝置接收到*OPC命令後，若TEST命令操作完成，那麼位元0(OPC位元)會被設為1。
2. 位元1：Not used
3. 位元2：查詢錯誤(QYE, Request Control)位元
位元2是用來反應輸出佇列偵測到錯誤發生，其情況為：
 - 當欲從輸出佇列讀出資料，但佇列裏卻無資料。
 - 資料在輸出佇列裏已經遺失。
4. 位元3：Not used
5. 位元4：執行錯誤(EXE, Execution Error)位元
位元4用來顯示有執行錯誤情況發生，為
 - 一個合法<程式訊息>命令不能夠適當地被執行時，應產生一執行錯誤訊息。
 - 當<程式訊息>裏的<程式資料>(即參數)之數值超過裝置允許之範圍時應產生一執行錯誤訊息。

6. 位元5:命令錯誤(CME,Command Error)命令

裝置裏的解譯器負責偵測命令錯誤產生,命令錯誤的發生為:

- 解譯器偵測出IE488.2語法錯誤(Syntax Error)◦例如命令格式與裝置收聽格式,不合成則是符合裝置收聽格式,不為裝置所接受(因裝置沒有實規)◦
- 當裝置接收到一不認識<程式表頭>時,解譯器須產生一命令錯誤訊息位於5◦

7. 位元6:Not used

8. 位元7:開關(PON,Power On)位元

位元7為開關位元,用來指示裝置的電源供應器由關至開的轉態狀態◦

6.2.3 GPIB介面功能 (選購OPT.109)

這是一個連接到BUS上設備的能力,是由設備本身所具備的介面功能而定◦這些功能在於提供設備可以經由BUS接收、操控和送出信息◦本分析儀除了輸入電壓必須使用背板上的切換開關選擇地以外,其餘的功能都能經由BUS控制◦

IEEE-488 INTERFACE	具有完整的Handshake的能力
	具有Talker/Listener的能力
	具有SERvice Request的能力
	沒有Remote/Local的能力
	沒有parallel poll的能力
	沒有Device Clear的能力
	沒有Device Trigger的能力
	沒有Controller的能力
	3 state driver
	設定測試狀態和參數
	讀取液晶顯示器上的資料
	讀取測試結果
可控制的項目	Test/ReSet控制
DATA CODES	ASCII
DELIMITER	CR + LF(+ EOI)

備註:本儀器的GPIB卡支援 結束碼 EOI 功能

IEEE 488.2必備命令

COMMAND	NAME	TEST TYPES
*IDN?	讀取裝置資訊	製造廠商,裝置型號,序列號碼,韌體版本
*RST	重置裝置	
*TST?	自我測試	00H=OK 01H=TEST FLASH ROM ERROR
*CLS	清除 ESR,STB 暫存器	

*OPC	同步命令(中段方式)	此命令是偵測上一命令(TEST)是否完成， 是ESR BIT0 設1
*OPC?	同步命令(輪詢方式)	此命令是偵測上一命令是否完成， 是 回傳01H
*WAI	等待命令	使用在命令與命令之間
*ESR?	讀取態況暫存器	01H(1)操作完成 10H(16)執行錯誤 20H(32)命令錯誤 80H(128)開機狀態
*ESE <NRf>	設定狀態暫致能暫存器	NRf=十進制，NRf=0~255
*ESE?	讀取狀態暫致能暫存器	0~255
*STB?	讀取狀態位元組暫存器	01H(1)ALL PASS 02H(2)FAIL 04H(4)ABORT 08H(8)Podcessing 20H(32)ESB BIT 40H(64)MSS 80H(128)Prompt
*SRE<NRf>	設定服務要求致能暫存器	NRf=十進制，NRf=0~255
*SRE?	讀取服務要求致能暫存器	0~255
*PSC	開機狀態清除命令	
*PSC?	開機狀態查詢命令	

6.2.4 GPIB位址

在GPIB(IEEE-488.2)介面Bus上的每個設備都必須有一個專用的位址，位址在出廠時已被預設為 8。

6.3 IEEE-488 通信範例

如要經由IEEE BUS設定輸出電壓為1240 volts時，請依照下列方式進行：第一先設定新資料夾(COMMAND:FN nn,xxxx)及記憶組位址(COMMAND:SS nn)，選擇ACW模式(COMMAND:SAA)，然後再傳送EV 1240字串，這是告訴儀器要將輸出電壓設定為AC 1240 volts。字串為一系列的ASCII characters、octal、hex bytes、特殊符號或包含雙括號在內。

如測試功能已被設定為ACW模式，而要ACW測試的緩昇時間經由IEEE BUS設定為10秒時，請傳送EDW 10.00 的字串，這告訴儀器要將ACW測試的緩昇時間設定為10秒。

如要設定掃瞄器通道1和2為高電壓輸出(High)，3和4為低電壓回路(Low)，4到8為開路(Off)時，請在ACW測試模式選擇之後，鍵入ES HHLLOOOO的字串，其他未被設定狀態的掃瞄器通道會自動被設為O(Open，開路)。

7400指令

下列指令被作為驅動ON/OFF功能或選擇各種參數表之用。執行這些指令時，不需使用任何其他數值或參數。然而在使用於某項特定功能(Function Specific)的指令時，這些功能選擇指令，如FC、FD、FE或FF必須要先執行，以便進入這項功能的參數。

指令	範圍	說明
FA		執行測試
FB		停止測試

指令設定範例

若要執行測試，指令為"FA"; 若要停止測試，指令為"FB"; 若要新增ACW的測試項，指令為"FC"。

ACW相關指令

指令	範圍	說明
FC		新增ACW測試項目
SA	0-5000	設定交流輸出電壓(Voltage)
SB	0.00-40.00	設定漏電電流上限(HI-Limit)
SC	0.000-9.999	設定漏電電流下限(LO-Limit)
SD	0.1-999.9	設定緩升時間(Ramp Time)
SE	0, 0.3-999.9	設定測試時間(Dwell Time)
SF	1-9	設定電弧靈敏度(Arc Sense)
SG	H=Hi、L=Low、O=Open	設定矩陣掃描器(Scanner)
SH	0-3.500	設定測線漏電電流歸零(Offset)
FI		設定輸出頻率(Frequency)為60Hz
FJ		設定輸出頻率(Frequency)為50Hz
FK		開啟電弧偵測判定模式(Arc Fail)功能
FL		關閉電弧偵測判定模式(Arc Fail)功能
FX		自動執行測線電阻歸零設定(Auto Offset)

指令設定範例

若ACW的"輸出電壓(Voltage)"要設定5000V，指令為"SA 5000"; 若ACW的"輸出頻率(Frequency)"要設定60Hz，指令為"FI"。

DCW相關指令

指令	範圍	說明
FD		新增DCW測試項目
SI	0-6000	設定直流輸出電壓(Voltage)
SJ	0-3500	設定漏電電流上限(HI-Limit)
SK	0.0-999.9	設定漏電電流下限(LO-Limit)
SL	0.4-999.9	設定緩升時間(Ramp Time)
SM	0, 0.3-999.9	設定測試時間(Dwell Time)
SO	0.0-350.0	設定最低充電電流(Charge-LO)
SP	1-9	設定電弧靈敏度(Arc Sense)
SQ	H=Hi、L=Low、O=Open	設定矩陣掃描器(Scanner)
SR	0-350.0	設定測線漏電電流歸零(Offset)
FM		開啟電弧偵測判定模式(Arc Fail)功能
FN		關閉電弧偵測判定模式(Arc Fail)功能
FV		自動執行最低充電電流設定(Auto Charge-LO)
FY		自動執行測線電阻歸零設定(Auto Offset)
F8		開啟緩衝電流設定(Ramp-HI)
F9		關閉緩衝電流設定(Ramp-HI)

指令設定範例

若DCW的"輸出電壓(Voltage)"要設定5000V，指令為"SI 5000"；若DCW的"電弧偵測判定模式(Arc Fail)功能"要設定為ON，指令為"FM"。

若ACW的"輸出電壓(Voltage)"要設定5000V，指令為"SA 5000"；若ACW的"輸出頻率(Frequency)"要設定60Hz，指令為"FI"。

IR相關指令

指令	範圍	說明
FE		新增IR測試項目
SS	100-1000	設定輸出電壓(Voltage)
ST	0.000-9.999	設定最低充電電流(Charge-LO)
SU	0-9999	設定絕緣電阻上限(HI-Limit)
SV	1-9999	設定絕緣電阻下限(LO-Limit)
SW	0, 0.5-999.9	設定判定延遲時間(Delay-Time)
SX	H=Hi、L=Low、O=Open	設定矩陣掃描器(Scanner)
FW		自動執行最低充電電流設定(Auto Charge-LO)

指令設定範例

若IR的"輸出電壓(Voltage)"要設定1000V，指令為"SS 1000"；若IR的"絕緣電阻下限(LO-Limit)"要設定為2MΩ，指令為"SV 2"。

PLC 時序

